PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-309139

(43)Date of publication of application: 02.11.2001

(51)Int,CI.

HO4N B41J 2/525 603G 15/01 GO6T HO4N HO4N 1/387 HO4N 1/40

(21)Application number: 2000-117105

(71)Applicant:

FUJI XEROX CO LTD

(22)Date of filing:

18.04.2000

(72)Inventor:

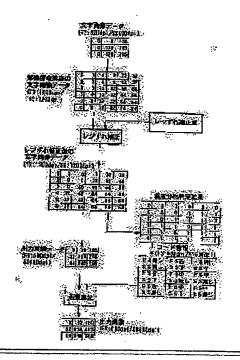
MURAMATSU SHIGEKI

(54) IMAGE FORMING DEVICE AND METHOD

(57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image forming device that can correct registration deviation with high precision without causing a remarkable increase in the device cost.

SOLUTION: Received character image data are converted into data with double resolution, registration deviation is corrected on the basis of a registration deviation correction amount, the deviation in the density distribution in an area is discriminated in the unit of areas consisting of 4 pixels equivalent to one pixel with the original resolution in the high resolution image data whose registration is corrected, and code in formation is set to each area depending on the result of discrimination. Then the high resolution image data are restored into the image data with the original resolution and a recording position of each pixel is fine-adjusted in a main scanning direction (FS) and a subscanning direction (SS) on the basis of the code information in the case of applying scanning exposure to the image.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.05.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-309139

(P2001-309139A)

(43)公開日 平成13年11月2日(2001.11.2)

(51) Int.CL'		識別記号	F I	· Ť	テーマコード(参考)	
H04N	1/29		H 0 4 N 1/29	G	2 C 2 6 2	
B41J	2/525	•	G O 3 G 15/01	Y	2H030	
G03G	15/01			s	5B057	
				112A	5 C 0 7 2	
		112	G 0 6 T 1/00	510	5 C O 7 4	
			審査請求 未請求 請求項の数7	OL (全35 頁)	最終頁に続く	

(21)出願番号

特願2000-117105(P2000-117105)

(22)出顧日

平成12年4月18日(2000.4.18)

(71)出顧人 000005496

宮士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂二丁目17番22号

(72)発明者 村松 茂樹

神奈川県海老名市本郷2274番地 富士ゼロ

ックス株式会社海老名事業所内

(74)代理人 100079049

弁理士 中島 淳 (外3名)

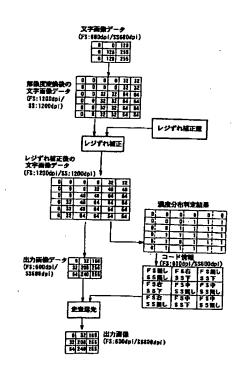
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画像形成装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 装置コストの大幅な増大を招くことなくレジ ずれを高精度に補正する。

【解決手段】 入力された文字画像データを2倍の解像度のデータに変換し、レジずれ補正量に基づいてレジずれ補正を行った後に、レジずれ補正後の高解像度画像データにおいて、元の解像度での1画素に相当する4画素から成る領域を単位として、領域内の濃度分布の偏倚を判定し、判定結果に応じて各領域にコード情報を設定する。次に高解像度の画像データを元の解像度の画像データに戻し、画像の走査露光に際しては、コード情報に基づいて画素の記録位置を主走査方向(FS)及び副走査方向(SS)に微調整する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数の画像データが表す複数の画像を、 画素を単位として各々形成し、形成した複数の画像を単 一の画像として合成する画像形成手段と、

前記複数の画像のレジずれを補正するためのレジ補正量 を、前記複数の画像の各部分毎に演算する演算手段と、 前記演算手段によって演算されたレジ補正量を、画像デ ータ上の個々の画素毎の値に対する修正量と、個々の画 素の記録位置に対する画素間隔未満の微調整量と、に分 解し、前記修正量に応じて画像データを修正する修正手 10 応じて画像データを修正し、 段と、

前記画像形成手段による前記複数の画像の形成が、前記 修正手段によって修正された画像データを用いて行わ れ、かつ前記微調整量に従って個々の画素の記録位置が 微調整されるように前記画像形成手段を制御する制御手 段と、

を含む画像形成装置。

【請求項2】 前記演算手段は、前記レジ補正量を、前 記画像形成手段による画像形成における主走査方向及び 副走査方向について各々演算し、

前記制御手段は、前記修正手段によって設定された個々 の画素の記録位置に対する主走査方向及び副走査方向の 微調整量に従い、個々の画素の記録位置が主走査方向及 び副走査方向に各々微調整されるように制御することを 特徴とする請求項1記載の画像形成装置。

【請求項3】 前記演算手段は、前記複数の画像のレジ ずれとして、レジずれ量が一定のDC成分及びレジずれ 量が周期的に変化するAC成分を各々検知し、検知した レジずれのDC成分及びAC成分に基づいて前記レジ補 正量を演算することを特徴とする請求項1記載の画像形 成装置。

【請求項4】 前記演算手段は、検知したレジずれのA C成分の周期、振幅及び位相に基づいて、前記AC成分 を補正するためのレジ補正量を前記複数の画像の各部分 毎に演算することを特徴とする請求項3記載の画像形成

【請求項5】 前記制御手段は、個々の画素の記録位置 に対する主走査方向の微調整量に従い、前記画像形成手 段が個々の画素を記録する期間を、個々の画素の記録周 期に相当する期間内で時間的にずらすことにより、画素 の記録位置を主走査方向に微調整させることを特徴とす る請求項2記載の画像形成装置。

【請求項6】 前記画像形成手段は、形成すべき画像に 応じて変調した光ビームを、帯電された感光体上で走査 させて静電潜像を形成することで画像の形成を行い、 前記制御手段は、個々の画素の記録位置に対する副走査 方向の微調整量に従い、個々の画素の記録位置における 静電潜像の電位の分布が副走査方向へ偏倚するように前 記感光体への光ビームの照射光量を制御することによ

特徴とする請求項2記載の画像形成装置。

【請求項7】 複数の画像データが表す複数の画像を、 画素を単位として各々形成し、形成した複数の画像を単 一の画像として合成するにあたり、

前記複数の画像のレジずれを補正するためのレジ補正量 を、前記複数の画像の各部分毎に演算し、

前記演算したレジ補正量を、画像データ上の個々の画素 毎の値に対する修正量と、個々の画素の記録位置に対す る画素間隔未満の微調整量と、に分解し、前記修正量に

前記複数の画像の形成を、前記修正した画像データを用 いて行うと共に、前記微調整量に従って個々の画素の記 録位置を微調整する画像形成方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は画像形成装置及び方 法に係り、特に、複数の画像を形成して合成する際のレ ジずれを抑制する画像形成方法、及び該画像形成方法を 適用可能な画像形成装置に関する。

20 [0002]

【従来の技術】デジタル複写機やプリンタ、ファクシミ リ、或いはこれらの機能を兼ね備えた複合機に搭載され る画像形成装置として、光学走査装置及び感光体ドラム を各々複数備え、各光学走査装置から射出された複数本 の光ビームを対応する像担持体上で各々走査(主走査) させることで各像担持体上に静電潜像を各々形成し、各 静電潜像を各色(例えばC、M、Y、K)に現像すると とで各色のトナー像を形成し、各色のトナー像を中間転 写体上で重ね合わせることで得られるカラー画像を単一 の記録材料に転写することで記録材料上にカラー画像を 形成する構成の画像形成装置は従来より知られている。 【0003】この種の画像形成装置では、画像形成装置 や光学走査装置を構成する各部品の寸法や取り付け位置 のばらつき、感光体ドラム等の回転駆動部材の偏芯、感 光体ドラム等の画像を担持する部材の画像形成面の移動 速度(副走査方向に沿った移動速度)のばらつき、装置 内部の温度変化に伴う各部品の位置ずれ等の原因によ り、画像の位置ずれやサイズのばらつき(以下、これら をレジずれと総称する)が生じる(このレジずれはカラ 一画像であれば色ずれ(カラーレジずれ)として視認さ

【0004】なお、レジずれは、より詳しくは図28に も示すように、(1) 副走査方向に沿った画像書き込み位 置のずれ、(2) 副走査方向に沿った画像の倍率のずれ (副走査方向に沿った画像領域の長さの変化)、(3)主 走査方向に沿った画像書き込み開始位置のずれ、(4)主 走査方向に沿った画像の倍率のずれ(主走査方向に沿っ た画像領域の長さの変化)、(5) 走査線の傾き(スキュ ー)、(6) 走査線の湾曲(ボウ)、(7) 画像の倍率の部 り、画素の記録位置を副走査方向に微調整させることを 50 分的なばらつき(画像の長さの部分的な変化:図28で

は例として、画像領域のうち主走査方向に沿って中央部分の画素間隔が「疎」、主走査方向に沿って両端部分の画素間隔が「密」の場合を示す)、(8) 画像の左右倍率のばらつき(主走査方向に沿った画像領域の長さの部分的な変化:図28では例として、画像領域のうち主走査方向に沿って一端側の部分の画素間隔が「疎」、主走査方向に沿って他端側の部分の画素間隔が「密」の場合を示す)の各種現象として現れる。

【0005】また、レジずれは変動形態によって2つの成分に分類することができる。レジずれのうち、レジず 10れの大きさ及び方向が少なくとも単一の画像内で一定となっている成分は、レジずれのDC成分と称している。レジずれのDC成分は、画像形成装置の機内温度が変化したり当該装置に外力が加わり、画像形成装置を構成する各ユニットや各部品の位置や大きさが微妙に変化することによって生ずる。一方、レジずれのうち、レジずれの大きさや向きが単一の画像内で周期的に変動している成分はレジずれのAC成分と称している。レジずれのAC成分は主として回転駆動部材が変動要因となっている(例えば、主走査方向には転写ベルトの端面プロファイ 20ルや感光体ドラムのウォブル、副走査方向には感光体ドラムやベルトドライブロールの偏芯、ベルト厚みのばらつき等)。

【0006】カラー画像を形成する画像形成装置におけるカラーレジずれの補正にあたっては、従来、例えば中間転写材等の上に各色のテストパターンを形成し、形成した各色のテストパターンの形成位置を検知し、テストパターンの形成位置のずれに応じて光学系を補正(例えば静電潜像の形成に用いる光ビームの光路を補正)することで画像形成位置のずれを補正する構成が一般的であった。

【0007】例えば特開昭63-300261号公報には、ステッピングモータ等のリニアアクチュエータを用いてミラー等の光学部品を調整することで光学系を補正する技術が開示されている。また、特開平2-308213号公報には、光学走査装置に内蔵のf θ レンズを、メカニカルアクチュエータで構成される回転調整手段によってピーム偏向面と略垂直な軸回りに回転させることで、画像の左右倍率のばらつきを補正する技術が開示されている。

【0008】また、上記の技術はメカニカルアクチュエータと電気的な補正を組み合わせることでカラーレジずれを補正するものであるが、カラーレジずれ補正を画像処理によって実現することで、必要なメカニカルアクチュエータの数を少なくしたり、メカニカルアクチュエータを不要とする補正方法も提案されている。

【0009】例えば特開平8-85237号公報には、 各バターン形成座標情報と所定の基準位置情報とから決 定されるずれ量に基づいて、各色毎の画像データの出力 座標位置を、レジストレーションずれを補正した出力座 50

標位置に自動変換し、画像データに基づいて変調された 光ビームの位置を最小ドット単位よりも小さい量で修正 する技術が開示されている。また特開平9-90695 号公報には、書き込み手段の走査線の屈曲歪み、傾きを 測定する測定手段と、この測定手段の測定結果に応じて 画像データを副走査方向に若しくは2次元的に補間して 補正するリサンブリング手段と、を備えた構成が開示されている。更に特開平6-91930号公報には、主走 査方向の解像度についてはクロック周波数を高くして調 整することにより得て、副走査方向の解像度については クオドスポット等を用いて解像度を高くすることで画素 の微小移動を行う技術が開示されている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開昭 63-300261号公報や特開平2-308213号 公報に記載の技術では、光学部品の位置や姿勢を高精度 に調整するために高価なアクチュエータ (具体的には、例えばステッピングモータ及びギア等) が必要となるので、画像形成装置のコストが嵩むという問題がある。【0011】また、特開平8-85237号公報や特開

平9-90695号公報、特開平6-91930号公報 に記載の技術は、何れもカラーレジずれのDC成分についての補正であり、主走査方向及び副走査方向にカラーレジずれのAC成分については何ら考慮されていない。従って、カラーレジずれのAC成分を低減するためには、回転駆動部材として偏芯等の小さい高精度・高価格の部品を使わざるを得ず、結果として画像形成装置のコストの大幅な増大を招いていた。

【0012】本発明は上記事実を考慮して成されたもので、装置コストの大幅な増大を招くことなくレジずれを 高精度に補正することができる画像形成装置及び方法を 得ることが目的である。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に請求項1記載の発明に係る画像形成装置は、複数の画 像データが表す複数の画像を、画素を単位として各々形 成し、形成した複数の画像を単一の画像として合成する 画像形成手段と、前記複数の画像のレジずれを補正する ためのレジ補正量を、前記複数の画像の各部分毎に演算 する演算手段と、前記演算手段によって演算されたレジ 40 補正量を、画像データ上の個々の画素毎の値に対する修 正量と、個々の画素の記録位置に対する画素間隔未満の 微調整量と、に分解し、前記修正量に応じて画像データ を修正する修正手段と、前記画像形成手段による前記複 数の画像の形成が、前記修正手段によって修正された画 像データを用いて行われ、かつ前記微調整量に従って個 々の画素の記録位置が微調整されるように前記画像形成 手段を制御する制御手段と、を含んで構成されている。 【0014】請求項1記載の発明では、画像形成手段に より、複数の画像データが表す複数の画像が、画素を単

位として各々形成され、形成された複数の画像が単一の 画像として合成される。なお、画像形成手段による画像 形成方式としては、例えば画像データが表す形成すべき 画像に応じて変調した光ビームを、帯電された感光体上 で走査させて静電潜像を形成することで画像の形成を行 う方式(所謂電子写真方式を採用することができるが、 公知の他の画像形成方式を用いてもよい。

【0015】また、画像形成方式として電子写真方式を 採用した場合、画像形成手段としては、複数の感光体を 有し、複数本の光ピームによって各感光体を同時に走査 10 露光して各感光体に各々画像を形成し、各画像を同一の 転写媒体上に重ね合せることによって単一の画像を形成 する構成(所謂タンデム方式)を採用すれば、画像の画 像の形成に要する時間を大幅に短縮することができる が、公知の他の構成を採用してもよいことは言うまでも ない

【0016】また、請求項1記載の発明は、複数の画像のレジずれを補正するためのレジ補正量を、複数の画像の各部分毎に演算する演算手段を備えている。この演算手段は、複数の画像のレジずれを検知する検知手段を含20み、検知したレジずれに基づいてレジ補正量を演算するように構成することができる。また、演算手段は複数の画像の各部分毎(画素毎であってもよいし、複数の画素から成る部分領域毎であってもよい)にレジ補正量を演算するが、これにより、複数の画像のレジずれに、レジずれ量が一定のDC成分及びレジずれ量が周期的に変化するAC成分が含まれていたとしても、これらが解消されるようにレジ補正量を演算・設定することが可能となる。

【0017】また、請求項1記載の発明では、演算手段 30 によって演算されたレジ補正量が、修正手段により、画像データ上の個々の画素毎の値に対する修正量と、個々の画素の記録位置に対する画素間隔未満の微調整量と、に分解され、前記修正量に応じて画像データが修正される。この修正量及び微調整量は、レジ補正量を画素間隔(画像形成手段によって形成される画像上での画素間隔)で除したときの商(修正量)及び剰余(微調整量)に相当し、前記修正量に応じて画像データが修正されることで、画素間隔を単位とするレジずれが画像データ上で補正されることになる。 40

【0018】そして、請求項1記載の発明では、画像形成手段による前記複数の画像の形成が、修正手段によって修正された画像データを用いて行われ、かつ前記微調整量に従って個々の画素の記録位置が微調整されるように、制御手段によって画像形成手段が制御される。これにより、画素間隔を単位とするレジずれが補正された画像データを用い、更に、画素間隔未満のレジずれに応じて個々の画素の記録位置が微調整されて画像が記録されるので、光学部品の位置や姿勢を調整するためのアクチュエータを設けたり、偏芯等の小さい高精度・高価格の

部品を回転駆動部材として用いたりすることなく、画像 形成手段によって形成される画像の画素間隔(記録密度)未満の小さなレジずれをも補正することができ、装置コストの大幅な増大を招くことなくレジずれを高精度 に補正することができる。

【0019】なお、本発明におけるレジずれの補正は、例えば画像形成手段による画像形成における主走査方向及び副走査方向のうちの何れか一方についてのみ行ってもよいが、例えば請求項2に記載したように、演算手段は、レジ補正量を、画像形成手段による画像形成における主走査方向及び副走査方向について各々演算し、制御手段は、修正手段によって設定された個々の画素の記録位置に対する主走査方向及び副走査方向の微調整量に従い、個々の画素の記録位置が主走査方向及び副走査方向に各々微調整されるように制御することが好ましい。

【0020】 これにより、画像形成手段によって形成される画像の画素間隔(記録密度)未満の小さなレジずれが、画像形成における主走査方向及び副走査方向について各々補正されるので、レジずれをより高精度に補正することができる。

【0021】また、請求項3に記載したように、演算手段は、複数の画像のレジずれとして、レジずれ量が一定のDC成分及びレジずれ量が周期的に変化するAC成分を各々検知し、検知したレジずれのDC成分及びAC成分に基づいてレジ補正量を演算することが好ましい。これにより、レジずれのDC成分及びAC成分を確実に補正することができる。

【0022】なお、レジずれのDC成分及びAC成分は、具体的には、例えば複数の画像に対応する複数種のマーク(レジずれの検出が容易なマーク:例えばシェブロンバターン等)を画像形成手段によって形成させて合成させ、合成された状態での複数種のマークの位置を光学的に検出し、各々のマークの位置のずれを、演算によりオフセット(DC成分)とずれ量が周期的に変動する成分(AC成分)とに分解し、AC成分については更にその周期(周波数)及び位相を演算することで検知することができる。また、レジずれのAC成分を補正するためのレジ補正量は、例えば請求項4に記載したように、検知したレジずれのAC成分の周期、振幅及び位相に基づいて、複数の画像の各部分毎に演算することができ

【0023】また、画像の個々の画素の画素の記録位置を主走査方向に微調整させることは、請求項5に記載したように、個々の画素の記録位置に対する主走査方向の微調整量に従い、画像形成手段が個々の画素を記録する期間を、個々の画素の記録周期に相当する期間内で時間的にずらすことで行うことができる。

て個々の画素の記録位置が微調整されて画像が記録され [0024]個々の画素を記録する期間を、個々の画素 るので、光学部品の位置や姿勢を調整するためのアクチ の記録周期に相当する期間内で時間的にずらすことは、 ュエータを設けたり、偏芯等の小さい高精度・高価格の 50 例えば光ビームを走査させることで画像を形成する態様 では、個々の画素を単位として光ビームを点灯させるタイミングをずらすことで実現することができ、例えばインクジェットヘッドからインク滴を吐出させることで画像を形成する態様においても、インクジェットヘッドからインク滴を吐出させるタイミングをずらすことで実現することができるので、比較的簡易な構成によって実現できる。従って請求項5記載の発明によれば、装置コストの増大を抑制することができる。

【0025】また、画像形成手段が、形成すべき画像に応じて変調した光ビームを、帯電された感光体上で走査 10 させて静電潜像を形成することで画像の形成を行う構成において、画素の記録位置を副走査方向に微調整させることは、請求項6に記載したように、個々の画素の記録位置に対する副走査方向の微調整量に従い、個々の画素の記録位置における静電潜像の電位の分布が副走査方向へ偏倚するように感光体への光ビームの照射光量を制御することで行うことができる。

【0026】個々の画素の記録位置における静電潜像の電位の分布が副走査方向へ偏倚するように感光体への光ビームの照射光量を制御することは、例えば光ビームを20射出する光源から射出される光ビームの光量を個々の画素を単位として制御することで実現することができるので、比較的簡易な構成によって実現できる。従って、請求項6記載の発明によれば、装置コストの増大を抑制することができる。

【0027】請求項7記載の発明に係る画像形成方法は、複数の画像データが表す複数の画像を、画素を単位として各々形成し、形成した複数の画像を単一の画像として合成するにあたり、前記複数の画像のレジずれを補正するためのレジ補正量を、前記複数の画像の各部分毎30に演算し、前記演算したレジ補正量を、画像データ上の個々の画素毎の値に対する修正量と、個々の画素の記録位置に対する画素間隔未満の微調整量と、に分解し、前記修正量に応じて画像データを修正し、前記複数の画像の形成を、前記修正した画像データを修正し、前記複数の画像の形成を、前記修正した画像データを用いて行うと共に、前記微調整量に従って個々の画素の記録位置を微調整するので、請求項1記載の発明と同様に、装置コストの大幅な増大を招くことなくレジずれを髙精度に補正することができる。

[0028]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施形態の一例を詳細に説明する。図1には本実施形態に係るカラー画像形成装置10が示されている。カラー画像形成装置10は、ブラテンガラス14上の所定位置に載置された原稿16を露光走査しCCDセンサ13により読み取って画像信号に変換する原稿読取装置12と、原稿読取装置12による読み取りによって得られた画像信号に基づいて、用紙50上にカラー画像を形成する画像形成装置18と、を備えている。

【0029】画像形成装置18は、CCDセンサ13に(50)リゴンミラー74の反射面で反射されることで所定方向

8

よる読み取りによって得られた画像信号をY.M.C.B k 各色のデジタル画像データに変換して蓄積する画像蓄積部82と、CPU、ROM、RAM等を含んで構成されカラー画像形成装置10における処理全般を制御する制御部80を備えている。カラー画像形成装置10の上面には、メッセージ等を表示するディスプレイ84Aと、オペレータが各種コマンド等を入力するためのキーボード84Bとを含んで構成された操作部84が設けられている。操作部84は制御部80と接続されている(図示省略)。

【0030】また画像形成装置18は、駆動ローラ32、34、36、38に巻き掛けられた無端の中間転写ベルト30を備えている。中間転写ベルト30は、トナー像を静電転写するためにカーボンにより体積抵抗が調整された誘電体であり、駆動ローラ32、34、36、38によって所定方向(駆動ローラ32、38間では図1の矢印B方向)に周回搬送される。

【0031】中間転写ベルト30の上側には、図1の矢印B方向に沿って、中間転写ベルト30上にY色のトナー像を形成する画像形成部20、中間転写ベルト30上にM色のトナー像を形成する画像形成部22、中間転写ベルト30上にC色のトナー像を形成する画像形成部24、中間転写ベルト30上にBk色のトナー像を形成する画像形成部26、及びパターン検出部28(詳細は後述)が順に設けられている。なお、画像形成部20,22,24,26は本発明の画像形成手段に対応している。

【0032】画像形成部20は、略円筒状で軸線を中心に図1の矢印A方向に回転可能とされ中間転写ベルト30に外周面が接するように配置された感光体20Cを備えており、感光体20Cの外周には、感光体20Cの外周面を所定の電位に帯電させる帯電器20Dが設けられており、図1の矢印A方向に沿って帯電器20Dよりも下流側には走査露光部20Aが設けられている。

【0033】図2に示すように、走査露光部20AはYの画像データに従って変調されたレーザビームを射出するレーザダイオード(LD)70を備えている。LD70のレーザビーム射出側には、コリメータレンズ71、平面ミラー72、73が順に配置されており、平面ミラー73のレーザビーム射出側には、外周に多数の反射面が形成されたポリゴンミラー74が配置されている。LD70から射出されたレーザビームは、コリメータレンズ71によって平行光束とされた後に、シリンドリカルレンズ等の図示しない光学部品により、ポリゴンミラー74の反射面幅よりも幅広の光束としてポリゴンミラー74の反射面に入射される(所謂オーバフィルド光学系)。

【0034】ポリゴンミラー74のレーザビーム射出側には、f θレンズ75、76が順に配置されている。ポリゴンミラー74の反射面で反射されるととで所定方向

に沿って偏向されたレーザビームは $f\theta$ レンズ75、76を透過し、シリンドリカルミラーや平面ミラー等から 成る折り返しミラー77で反射されて走査露光部20A から射出され、ミラー20Hを介して感光体20Cの外 周面上に照射される。感光体200に照射されるレーザ ビームは、ポリゴンミラー74の回転に伴って、感光体

200の軸線に平行な方向に沿って感光体200の周面 上を走査(主走査)される。なお、副走査は感光体20 Cが回転することによって成される。これにより、感光 体200の外周面上の帯電された部分に画像のY色成分 10

に対応した静電潜像が形成される。

【0035】また、折り返しミラー77のレーザピーム 射出側のうち、レーザビームの全走査範囲のうち走査開 始側の端部 (SOS:Start Of Scan) に相当する位置に は開始位置検出センサ78が配置されている。LD70 から射出されたレーザビームは、ポリゴンミラー74の 各反射面のうちのレーザビームを反射している面が、入 射ビームをSOSに相当する方向へ反射する向きとなっ たときに、折り返しミラー77を介して開始位置検出セ ンサ78に入射され、開始位置検出センサ78から開始 20 位置信号SOS が出力される。

【0036】一方、感光体200の外周面へのレーザビ ーム照射位置よりも図1の矢印A方向に沿って下流側に は、現像装置20B、転写装置20F及びクリーニング 装置20Eが順に設けられている。現像装置20Bは、 トナー供給部20GよりY色のトナーが供給され、走査 露光部20Aにより形成された静電潜像をY色のトナー によって現像しY色のトナー像を形成させる。また、転 写装置20Fは中間転写ベルト30を挟んで感光体20 Cの外周面と対向するように配置されており、感光体2 30 0 Cの外周面に形成されたY色のトナー像を中間転写べ ルト30の外周面に転写する。また、トナー像転写後に 感光体20Cの外周面に残存しているトナーはクリーニ ング装置20Eによって除去される。

【0037】なお、図1より明らかなように、画像形成 部22、24、26の構成は画像形成部20の構成と同 一である(但し、形成するトナー像の色は互いに異な る)ので説明を省略する。画像形成部20、22、2 4、26は、各々が形成した各色のトナー像が中間転写 ベルト30の外周面上で互いに重なり合うようにトナー 像を転写させる。これにより、中間転写ベルト30の外 周面上にフルカラーのトナー像が形成される。

【0038】また、中間転写ベルト30の周回路に沿っ て、画像形成部20よりも中間転写ベルト30の周回方 向上流側には、中間転写ベルト30のトナーの吸着性を 良好にするために中間転写ベルト30の表面電位を所定 電位に維持する吸着ローラ40、中間転写ベルト30か **らトナーを除去するクリーニング装置42、中間転写べ** ルト30上の予め定められた基準位置(例えば光反射率 の高いシール等から成るマークが付されている)を検出 50 な平行四辺形状とされている。フォトダイオード96

する基準位置検出センサ44が順に設けられている。

【0039】一方、中間転写ベルト30配設位置の下方 には、多数枚の用紙50を積層状態で収容するトレイ5 4が設けられている。トレイ54に収容されている用紙 50は、引出しローラ52の回転に伴ってトレイ54か ら引出され、搬送ローラ対55、56、58によって転 写位置(駆動ローラ36及び転写ローラ60が配設され ている位置) へ搬送される。転写ローラ60は中間転写

ベルト30を挟んで駆動ローラ36と対向するように配 置されており、転写位置へ搬送された用紙50は、転写 ローラ60と中間転写ベルト30とに挟持されることに

より、中間転写ベルト30の外周面上に形成されたフル カラーのトナー像が転写される。トナー像が転写された 用紙50は、搬送ローラ対62により定着装置46へ搬 送され、定着装置46によって定着処理が施された後、

用紙トレイ64へ排出される。

【0040】次にパターン検出部28の構成について説 明する。図3に示すように、パターン検出部28は3個 のパターン検出ユニット90A、90B、90Cを備え ている。このパターン検出ユニット90A~90Cは、 中間転写ベルト30の幅方向に沿って中央及び両側(中 間転写ベルト30の幅方向に沿って画像領域の中央及び 両端に対応する位置)の3カ所の上方に各々配置されて いる。なお、図3は中間転写ベルト30の外周面上に画 像位置検出用バターン (シェブロンパターン) が形成さ れている状態が示されている。パターン検出ユニット9 OA~90Cは互いに同一の構成であるので、以下では パターン検出ユニット90Aを例に、図4及び図5を参 照して構成を説明する。

【0041】図4に示すように、パターン検出ユニット 90Aは一対の反射光量検出部92A, 92Bを備えて いる。なお、図4では反射光量検出部92Aに「D 1」、反射光量検出部92Bに「D2」の符号を付して 各々を区別している。反射光量検出部92Aは、単一の LED94と2個のフォトダイオード96A、96Bを 備えており、同様に反射光量検出部92Bも単一のLE D98と2個のフォトダイオード100A, 100Bを 備えている。

【0042】図5(A)に示すように、反射光量検出部 92A, 92BのLED94, 98は、中間転写ベルト 30の幅方向に沿って中間転写ベルト30の外周面上の 若干ずれた位置に光を照射するように向きが調整されて いる(一例として図6には、中間転写ベルト30を一定 速度で搬送したときの中間転写ベルト30の外周面上で のLED94、98の照射位置の軌跡を個々のパターン 検出ユニット毎に2本の想像線で各々示す)。

【0043】一方、図5(B)に示すように、反射光量 検出部92A、92Bの計4個のフォトダイオード96 A,96B,100A,100Bは、受光面が各々扁平 A、96Bの受光面は互いの長辺同士が接することで単一の平行四辺形状の受光面領域を形成しており、同様にフォトダイオード100A、100Bの受光面も互いの長辺同士が接することで単一の平行四辺形状の受光面領域を形成しており、フォトダイオード96A、96Bの受光面領域とフォトダイオード100A、100Bの受光面領域は、単一の略L字状(略山型)の受光面領域を形成するように互いの短辺同士が接している。

【0044】フォトダイオード96A、96B、100A、100Bによる中間転写ベルト30の外周面上での10検出範囲は、上記の受光面領域の形状に対応して略山型(略L字状)になる(図6の個々のパターン検出ユニットのブロックの中に、中間転写ベルト30の外周面上での検出範囲を表す図形を示す)が、フォトダイオード96A、96B、100A、100Bは、後述するシェブロンパターンの形状に合わせて、中間転写ベルト30の外周面上での検出範囲の略山型の頂部に相当する位置が、中間転写ベルト30の移動方向に沿った最上流側に位置するように各々配置されている。

【0045】とれにより、中間転写ベルト30の外周面 20上での反射光量検出部92Aのフォトダイオード96A、96Bの検出範囲は、反射光量検出部92AのLED94の照射位置の軌跡を各々跨ぎ、かつ中間転写ベルト30の移動方向に沿って互いにずれた位置に位置するととになり、LED94から射出され中間転写ベルト30の外周面(又は外周面上に形成された画像)によって反射された光はフォトダイオード96A、96Bで各々受光される。

【0046】同様に、中間転写ベルト30の外周面上での反射光量検出部92Bのフォトダイオード100A,100Bの検出範囲は、反射光量検出部92BのLED98の照射位置の軌跡を各々跨ぎ、かつ中間転写ベルト30の移動方向に沿って互いにずれた位置に位置することになり、LED98から射出され中間転写ベルト30の外周面(又は外周面上に形成された画像)によって反射された光はフォトダイオード100A,100Bで各々受光(光量検出)される。

【0047】図4に示すように、フォトダイオード96 Aの出力端は電流-電圧変換器102、増幅器104、A/D変換器106を介して制御部80のマイクロコン 40 ビュータ108に接続されており、フォトダイオード96 Aから出力される受光量に応じた大きさの電流は、フォトダイオード96 Aの出力電圧を表すデジタルデータに変換されてマイクロコンビュータ108に入力される。マイクロコンビュータ108はLEDドライバ110を介してLED94に接続されている。マイクロコンビュータ108は、LEDドライバ110を介してLED94に供給する駆動電流を制御する。

【0048】また、フォトダイオード96Bの出力端は 下、便宜的に「山型パターン」と称する)を基本パター 電流-電圧変換器112を介して差動入力増幅器114 50 ンとし、3個の山型パターンが一定間隔毎に形成されて

12

の2個の入力端に接続されており、2個の入力端の他方には電流-電圧変換器102の出力端が接続されている。差動入力増幅器114は、電流-電圧変換器112、102から入力された信号の差分(フォトダイオード96A、96Bの受光量差に相当)を増幅して出力する。なお、図6にはパターン検出部28がシェブロンパターンを検出した際の差動入力増幅器114の出力電圧のおおよその変化を、シェブロンパターン132と対応させて示す。

【0049】差動入力増幅器114の出力端はコンパレータ116、パッファ118、カウンタ120を介してマイクロコンピュータ108に接続されている。コンパレータ116は、差動入力増幅器114から入力された信号のレベルを予め設定された関値と比較し、信号のレベルが関値以上のときには出力信号をハイレベル(便宜的に「ON」という)、信号のレベルが関値未満のときには出力信号をローレベル(便宜的に「OFF」という)に切替える。コンパレータ116からの出力信号は、パッファ118を介してカウンタ120へ入力される。

【0050】カウンタ120は、入力された信号のレベルが「OFF」から「ON」に切り替わるとカウントを開始し、信号のレベルが「ON」から「OFF」に切り替わった後に再度「OFF」から「ON」に切り替わると、それまでのカウント値をマイクロコンピュータ108へ出力すると共にカウント値をリセットし、次に信号のレベルが「OFF」から「ON」に切り替わる迄の時間をカウントするととを繰り返す。

【0051】マイクロコンピュータ108は、後述する 画像位置補正時(パターン検出部28がシェブロンパタ ーンを検出した時)に、カウンタ120から入力された カウント結果に基づいてシェブロンパターンの位置を検 出し、画像形成部20、22、24、26による画像の 形成位置を補正する。

【0052】なお、反射光量検出部92Bのフォトダイオード100A、100Bにも反射光量検出部92Aと同一構成の回路が接続されているので、接続されている回路の各部に同一の符号を付し(図4)、説明を省略する

【0053】次に本実施形態の作用を説明する。レジずれ補正に際し、マイクロコンピュータ108は、図6に示すようなシェブロンパターン132が中間転写ベルト30の外周面上に形成されるように画像形成部20,22,24,26を制御する。本実施形態に係るシェブロンパターン132は、図6に示すように、検出部の受光面の形状(図5(B)参照)と略同様に略山型(略L字状)で、山型の頂部に相当する位置が副走査方向に沿った最上流側に位置するように形成されるパターン(以下、便宜的に「山型パターンが一定関隔無に形成されて

(8)

*が「OFF」となっている期間は検出器が山型パターン を検出していない期間(山型パターンの間隙を検出して

いる期間)に相当する。従って、カウンタ120から入

成るパターン群が、副走査方向に沿って多数形成されて 構成されている。

【0054】各山型パターンは、Y、M、C各色のトナ ーのうちの少なくとも1色のトナーにより形成されると とでY、M、C3色のうちの少なくとも1色を含んでい ると共に、同一のパターン群に含まれる3個の山型パタ ーンは、互いに他の山型パターンと少なくとも部分的に 異なる色で形成されている。

【0055】中間転写ベルト30に上記のシェブロンバ ターン132が形成されると、パターン検出部28によ 10 るシェブロンパターン132の検出が行われる。こと で、中間転写ベルト30の外周面上でのフォトダイオー ド96A、96Bによる検出範囲は副走査方向にずれて いるため、シェブロンパターン132の検出時には、差 動入力増幅器114からは、電流-電圧変換器112, 102から入力された信号の差分(フォトダイオード9 6A、96Bの受光量差) に相当する波形、すなわち図 6に「検出波形」として示すように、中間転写ベルト3 0の外周面上でのフォトダイオード96A、96Bによ る検出範囲を単一の山型パターンが横切る毎に、出力信 20 号のレベルが負方向及び正方向にパルス状に変化する波 形の信号が出力される。

【0056】差動入力増幅器114の出力信号はコンパ レータ116に入力され、コンパレータ116によって 上記出力信号のレベルが予め設定された閾値と比較され る。コンパレータ116は、入力された信号のレベルが 関値以上のときには出力信号のレベルを「ON」とし、 入力された信号のレベルが閾値未満のときには出力信号 のレベルを「OFF」とする。コンパレータ116から 出力された信号はバッファ118を介してカウンタ12 30 がSS方向にずれている場合には、時間間隔a,b, 0に入力され、信号のレベルが「OFF」から「ON」 に切り替わる時間間隔が順次カウントされる。カウンタ 120によるカウント値は、パターン検知信号(図7参 照)としてマイクロコンピュータ108に入力される。 【0057】マイクロコンピュータ108には、パター ン検知信号として、単一のパターン検出ユニット90当 り2個(合計6個)のカウンタ120からカウント値が 各々入力される。コンパレータ116から出力される信 号において、レベルが「ON」となっている期間は検出 器が山型パターンを検出している期間に相当し、レベル*40

 $FS_{err}[sec] = \frac{1}{2}(b-a)$

FS_{err}[m]=FS_{err}[sec]・(単位時間当りの距離:換算値)

 $SS_{err}[sec] = (d-c) - \frac{1}{2}(b-c)$

SS., [m] = SS., [sec]・(単位時間当りの距離:換算値)

【0062】これにより、FS方向に沿った各位置(S OS付近、COS (Center Of Scan)付近、及びEOS (E 力されるカウント値はシェブロンパターン132におけ る山型パターンの形成間隔を表している。 【0058】図7には、マイクロコンピュータ108に よって実現される各種の機能のうちレジ補正に係る機能 (以下、この機能を実現するためのソフトウェア及びハ ードウェアをレジ補正部130と総称する)が、詳細な

機能毎にブロックに分けて示されている。レジ補正部1 30は、入力されたパターン検知信号に基づいてレジず れのDC成分及びAC成分を各々検知し、レジずれのD C成分については検知したレジずれ量を補正するための 補正量を演算するレジずれ補正量演算部133を有して いる。なお、レジずれ補正量演算部133は本発明の演 算手段に対応している。

【0059】レジずれ補正量演算部133は、各カウン タ120から入力されるカウント値に基づいて、シェブ ロンパターン132内の各部位における山型パターンの 形成時間間隔(図8(A)に示す時間間隔a, b, c, d)を検知する。単一のパターン検出ユニット90から 入力される2個のカウント値から求めた時間間隔a, b, c, dは、主走査方向(以下、FS(Fast Scan)方 向という)及び副走査方向(以下、SS(Slow Scan)方 向という) についてバターン形成位置のずれが無けれ ば、図8 (B) に示すように互いに等しい値 (a = b = c = d) となるが、図8(C) 又は(D) に示すように バターンの形成位置がFS方向にずれている場合、或い は図8(E)又は(F)に示すようにパターン形成位置

c、dの少なくとも何れかの値が他の値と相違する。 【0060】とのため、レジずれ補正量演算部133 は、下記の演算式に従い、特定の色(例えばY)を基準 として他の3色(例えばM, C, Bk)のFS方向の色 ずれ量FS...及びSS方向の色ずれ量SS...を演算す ることを、パターン検出ユニット90A,90B,90 Cについて各々行う。

[0061]【数1】

S方向について各々検知される。そして、或る色につい てのSOS付近、COS付近、及びEOS付近における nd Of Scan)付近)における色ずれ量がFS方向及びS 50 色ずれ量FS。,,, SS。,, に基づいて、FS方向に沿っ

た位置(座標値y)と色ずれ量FS.,, SS.,, との関 係(例として図9に実線で示す関係)を求め、更に、座 標値yから色ずれを補正するための色ずれ補正量を演算 するための演算式 (この演算式が表す座標値 y と色ずれ 補正量との関係を例として図9に破線で示す)をFS ...及びSS...について各々求めることを、基準色以外 の3色について各々行う。

【0063】上記で求めた演算式に画像上のFS方向に 沿った各位置における座標値yを代入することにより、 画像上のFS方向に沿った各位置における色ずれ補正量 10 を求めることができ、この色ずれ補正量に基づいて各画 素の位置を各色毎に独立に補正することで色ずれを補正 することができる。なお、図9はSOS付近における色 ずれ量とCOS付近における色ずれ量との偏差、及びC OS付近における色ずれ量とEOS付近における色ずれ 量との偏差が等しい場合を示しているが、実際には両者 は一致するとは限らない。両者が等しくない場合、FS 方向に沿った位置と色ずれ量との関係や、FS方向に沿 った位置から色ずれ補正量を求める演算式は、例えば最米

* 小二乗法等を適用して求めればよい。

【0064】また、レジずれ補正量演算部133は、パ ターン検出ユニット90A, 90B, 90Cでシェブロ ンパターン132が検出されたタイミング、及びパター ン検出ユニット90A、90B、90Cの検出位置に対 するシェブロンパターンの形成位置のずれ量に基づい て、走査線傾き (スキュー)、走査線湾曲 (ボウ)、全 体倍率変化及び左右倍率変化を各々検知し、それぞれを 補正するための補正量を求める。

【0065】走査線傾きについては、図10(A)に示 すように、パターン検出ユニット90A、90B、90 Cの検出位置におけるシェブロンパターン132の形成 位置のxy座標(x₁, y₁)(x, y)(x₂, y₂)を 各々検知し、その位置関係(図10(B)参照)に基づ き、以下の演算式に従って走査線傾き量を演算し、FS 方向に沿った位置(座標値y)から走査線傾きに対する 補正量を演算するための演算式を求める。

[0066]

【数2】

$$\frac{y_2 - y}{x_2 - x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad y = y_2 - \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x_2 - x)$$

(9)

走査線傾き (スキュー) 補正量演算式

$$\frac{y_2 - y}{x_2 - x} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \qquad y = y_2 + \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} (x_2 - x)$$

【0067】上記で求めた演算式に画像上のFS方向に 沿った各位置における座標値yを代入することにより、 正量を求めることができ、この走査線傾き補正量に基づ いて各画素の位置を補正することで走査線傾きを補正す ることができる。

【0068】また、走査線湾曲については、シェブロン バターン 1 3 2 の形成位置の x y 座標 (x,, y,)

※ (x, y) (x, y,) に基づき、以下の演算式に従っ て、走査線湾曲として角度θ, x, y (図11も参照) 画像上のFS方向に沿った各位置における走査線傾き補 30 を各々演算し、FS方向に沿った位置(座標値y)から 走査線湾曲に対する補正量を演算するための演算式を求

> [0069] 【数3】

走査線湾曲(ポウ)演算式

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y_2}{x_2} \qquad x = r\cos\theta \qquad y = \frac{y_0}{2} \left(e^{\frac{x}{y_0}} + e^{-\frac{x}{y_0}} \right) = y_0 \cosh \frac{x}{y_0}$$

走査線湾曲 (ボウ) 檜正量演算式

$$y = -y_0 \cosh \frac{x}{y_0}$$

【0070】上記で求めた演算式に画像上のFS方向に 沿った各位置における座標値yを代入することにより、 画像上のFS方向に沿った各位置における走査線湾曲補 正量を求めることができ、この走査線湾曲補正量に基づ いて各画素の位置を補正することで走査線湾曲を補正す ることができる。

【0071】また、全体倍率変化及び左右倍率変化につ いては、まずパターン検出ユニット90Aの検出位置に 50 おけるシェブロンパターン132の形成位置と検出位置 とのFS方向に沿った偏差 AXL、パターン検出ユニッ ト900の検出位置におけるシェブロンパターン132 の形成位置と検出位置とのFS方向に沿った偏差AX。 (図12参照)を各々求め、以下の演算式に従って全体 倍率に対する補正量を求める。

[0072]

【数4】

全体倍率補正量= $\frac{(\Delta X_L - \Delta X_R) + (左右レジ検出位置間距離)}{}$

(左右レジ検出位置間距離)

[0073]また、左右倍率変化(発生原因については 図13 (B) を参照) については、前述の偏差 ΔX,, △X。に加え、パターン検出ユニット90Bの検出位置 におけるシェブロンバターン132の形成位置と検出位 置とのFS方向に沿った偏差AX。(図13(A)参 * *照)も求め、以下の演算式に従って左側倍率及び右側倍 率に対する補正量を各々求める。

[0074]

【数5】

左側倍率補正量=パランスずれ+全体倍率補正量

= (ΔX_L-ΔX_C)・(左右レジ検出位置間距離) +全体倍率補正量 (左右レジ検出位置間距離)

右側倍率補正量=バランスずれ+全体倍率補正量

= (ΔX_C-ΔX_R)・(左右レジ検出位置間距離) +全体倍率補正量 (左右レジ検出位置問距離)

【0075】上記で求めた倍率補正量に従い、COSに 相当する画素を中心として左側(図13ではEOS側) の領域については、FS方向に沿った画素間隔を左側倍 率補正量に従って補正し、COSに相当する画素を中心 として右側(図13ではSOS側)の領域については、 FS方向に沿った画素間隔を右側倍率補正量に従って補 20 正することで、全体倍率変化及び左右倍率変化を補正す ることができる。なお、上記の色ずれ、走査線傾き、走 査線湾曲、全体倍率変化、左右倍率変化は何れもレジず れのDC成分に相当する。

【0076】次にレジずれのAC成分の検知について説 明する。FS方向のレジずれのAC成分は、主として感 光体20C, 22C, 24C, 26Cのウォブル、中間 転写ベルト30の端面プロファイルに起因して発生す る。例として図14(A)に示すように、感光体の軸線 に対して実際の回転軸が傾いていることで感光体のウォ ブルが生じていた場合、走査露光部による走査露光位置 において、感光体の周面の位置がFS方向に周期的に変 動することにより、図14(B)に示すように、感光体 の周面上への画像の形成位置がFS方向に沿って周期的 に変動する。

【0077】とのため、レジずれ補正量演算部133 は、何かの基準信号(例えば感光体に取付けたロータリ ーエンコーダの Z相の信号) に基づいて、感光体の回転 の1周期におけるFS方向に沿ったシェブロンパターン 132の形成位置を所定のサンプリング周波数(シャノ ンの定理によればサンプリング周波数は再生周波数の2 倍とすればよいが、ノイズの影響を考慮すると最低でも 再生周波数の6~10倍とすることが望ましい)でサン ブリングし、サンブリング結果に基づいて画像形成位置 のFS方向に沿った変動の周期、振幅及び位相(感光体 の周面上の位置との関係)を検知する。

【0078】上記で検知したFS方向ACレジずれの検 知結果(画像形成位置のFS方向に沿った変動の周期、 振幅及び位相) に基づき、各画素のFS方向に沿った位 置を、検知した画像形成位置のFS方向に沿った変動を 50 に伴って画素間隔の変動の振幅及び位相がFS方向に沿

打ち消すように周期的に変化させる(周期、振幅を同一 とし位相を逆位相とする) 補正量を設定し、該補正量に 従って補正を行うことにより、画像形成位置のF S方向 に沿った変動を補正することができる。

【0079】また、SS方向のレジずれのAC成分は、 主として感光体20C, 22C, 24C, 26Cや中間 転写ベルト30を駆動する駆動ローラ32,34,3 6,38の偏芯、中間転写ベルト30の厚みの不均一性 等に起因して発生する。例として図14(C)に示すよ うに、感光体の軸線に対して実際の回転軸が偏芯してい た場合、走査露光部による走査露光位置において、感光 体の周速が周期的に変動することによりSS方向に沿っ た画素間隔が周期的に変動する。この画素間隔の周期的 な変動は、例えば濃度が一定の領域内においては、図1 4 (D) に示すようにSS方向に沿った周期的な濃度変 動として視認される。

【0080】とのため、レジずれ補正量演算部133 は、何かの基準信号(例えば感光体に取付けたロータリ ーエンコーダの Z相の信号) に基づいて、感光体の回転 の1周期におけるSS方向に沿ったシェブロンパターン 132の形成位置を所定のサンプリング周波数でサンプ リングし、サンブリング結果に基づいてSS方向に沿っ た画素間隔の変動の周期、振幅及び位相(感光体の周面 上の位置との関係)を検知する。

【0081】上記で検知したSS方向のACレジずれの 検知結果(SS方向に沿った画素間隔の変動の周期、振 幅及び位相) に基づき、SS方向に沿った画素間隔を、 検知したSS方向に沿った画素間隔の変動を打ち消すよ うに周期的に変化させる(周期、振幅を同一とし位相を 逆位相とする) 補正量を設定し、設定した補正量に従っ て補正を行うことにより、SS方向に沿った画素間隔の 変動を補正することができる。

【0082】なお、感光体の回転軸が傾いていることに よるウォブルが生じていた場合、感光体の周速の変動の 振幅及び位相がFS方向に沿った各位置で相違し、これ

18

った各位置で相違することになる。このため、上記を考慮すると、SS方向に沿った画素間隔の変動の周期、振幅及び位相の検知をSOS、COS、EOSの各位置で各々行い、検知結果に基づき、FS方向に沿った各位置における、SS方向に沿った画素間隔の変動の周期、振幅及び位相を補間演算によって求め、演算結果に基づいてSS方向に沿った画素間隔の変動を補正することが望ました。

【0083】また写真画像等のように、画像の幾何学的な歪み(具体的には、画像形成位置のFS方向に沿った10変動やSS方向に沿った画素間隔の変動)は目立たないものの、濃度の周期的な変動は顕著に視認される画像に対しては、上述したFS方向に沿った画素位置及びSS方向に沿った画素間隔の補正に代えて、濃度の補正のみを行うようにしてもよい。この場合、シェブロンパターン132に代えて、濃度が一定のベタ画像を形成し、形成したベタ画像のFS方向及びSS方向に沿った濃度変動の周期、振幅(濃度変動幅)及び位相を検知することが望ましく、検知した濃度変動の周期、振幅及び位相に基づき、検知した濃度変動が打ち消されるように各画素20の濃度を周期的に変化させる補正を行えばよい。

【0084】一方、レジ補正部130には、画像形成部 20, 22, 24, 26によって形成すべき画像を表す 画像データも入力される。なお、この画像データは原稿 読取装置12が原稿を読み取ることで得られた画像デー タであってもよいし、電話回線を介して他のファクシミ リ装置から受信した画像データであってもよいし、通信 回線を介してバーソナルコンピュータ(PC)等の情報 処理装置から受信したデータをビットマップデータとし て展開することで得られた画像データであってもよい。 【0085】また、本実施形態では、上記の画像データ として、形成すべき画像をFS方向及びSS方向に60 Odpiの解像度で多数の画素に分解すると共に、各画 素のY、M、C、Bk各色毎の濃度を各々8ビット(O ~255の256階調)で表す画像データを用いている が、画像データの解像度及び階調数は上記数値に限定さ れるものではない。

【0086】レジ補正部130はオブジェクトタグ付加部134を備えており、上記の画像データはオブジェクトタグ付加部134に入力される。オブジェクトタグ付40加部134は入力された画像データを画素単位で解析し、入力された画像データが「2値展開文字」「写真」「グラフィックス」「多値展開文字」の何れを表す画像かを分類し、分類結果を表すオブジェクトタグ(例えば表1に示す2ビットの情報)を画像データに付加して出力する。なお、表1において、()bは括弧内の数値が2進数であることを表す。

[0087]

【表1】

20

分類	オブジェクトタグ
2 値展開文字	(00) b
写真	(01) b
グラフィックス	(10) b
多值展開文字	(11) b

【0088】通常、文字原稿データにおける個々の文字 のデータは、文字コード、フォント種を示す情報、及び 文字の大きさを示す情報から構成されており、アウトラ インフォント (ベクトルフォント) を使用した場合の画 像データの生成は、指定された文字コード、フォント種 に対応するフォントデータ(文字の輪郭線を表すデー タ)を呼び出し、フォントデータが表す輪郭線の大きさ を指定された文字の大きさに応じて拡大又は縮小してビ ットマップメモリ上に展開し、輪郭線内を特定の色で塗 り潰すことによって成される。上記のように生成された 画像データは、個々の画素の濃度値が文字部分に相当す る値(例えば255)か、又は下地部分に相当する値 (例えば0)になる。本実施形態では、このような画像 データを「2値展開文字」の画像データと称している。 【0089】一方、アウトラインフォントを使用した場 合の文字の描画精度は、画像記録時の解像度より高いと とが一般的であるため、フォントデータが表す文字の輪 郭線(外形形状)は、画像記録時の解像度と同等のビッ トマップメモリ上にフォントを展開する段階で、画像記 録時の解像度に合わせて量子化されることになり、輪郭 線がきざつく等の文字原稿の記録品質の劣化が生ずる。 この量子化による記録品質の劣化を抑制する方法として は、画像記録時の解像度よりも高解像度のビットマップ メモリ上にフォントを展開して2値展開文字の画像デー タを取得した後に、画像記録時の解像度と同等の画像デ ータへ解像度変換する方法がある。この場合、文字部分 と下地部分の境界に位置している画素は、文字部分に相 当する値と下地部分に相当する値の間の値になる。本実 施形態では上記のようにして得られる画像データを「多 値展開文字」の画像データと称している。

【0090】なお、本実施形態では、後述するようにレジずれの補正に際して画像データをより高解像度の画像データ(FS方向及びSS方向の解像度が1200dp1の画像データ)に変換するので、アウトラインフォントの高い描画精度を生かすために、上記の解像度変換後の解像度と同等の高解像度のビットマップメモリ上にフォントを展開し、得られた画像データを画素位置補正演算部146(後述)へ直接入力するようにしてもよい。【0091】オブジェクトタグ付加部134における分類方法は、画像データを上記の表1のように分類できる方法であれば、どのような方法を適用可能である。一例として、注目画素を中心とした所定の画素数から成る矩形領域内の全画素について、注目画素からの距離に応じた重み付けを施した後に統計処理を行い、統計処理の結

果 (例えば濃度ヒストグラムの形状) に基づいて当該注目画素を分類する方法を適用することができる。この場合、例えば注目画素が2値展開文字の画像データに属する画素であれば、特定の濃度値の画素数が突出した濃度ヒストグラムが得られる(図15参照)ので、濃度ヒストグラムの形状に基づいて注目画素の種類を特定することができる。

【0092】また、画像データが表す画像中に、文字に 相当するシャドー部が存在するか否かを探索したり、シャドー部に代えて網点パターンや一定の特徴を有する小 10 行う。領域を適用して分類する方法や、ユーザによって指定させる方法を用いてもよい。また、PCで実行されるアプリケーションの中にはオブジェクトタグと同一又は類似のタグを付加するものがあり、これを利用してもよい。 オブジェクトタグ付加部134による分類により、入力された画像データが表す画像中に文字画像や写真画像が 混在していたとしても、これらは異なる画像データとして分類される。 4個

【0093】なお、上記のように、入力された画像データを「2値展開文字」「写真」「グラフィックス」「多 20値展開文字」の4種類に分類することに代えて、「2値展開文字」及び「多値展開文字」を含むグループ(濃度が急激に変化しているエッジ部分の再現性が重視されると共に、画像の幾何学的な歪みが目につき易い画像に対応するグループ)と、「写真」及び「グラフィックス」を含むグループ(中間調の再現性が重視されるデータのグループ)の2種類に分類してもよい。

【0094】オブジェクトタグ付加部134によってオブジェクトタグが付加された画像データは、バッファ136に一旦保持された後に、付加されているオブジェクトタグに基づいて、「2値展開文字」及び「多値展開文字」の画像データ(以下、文字画像データと総称する)は文字画像処理部138へ入力され、「写真」及び「グラフィックス」の画像データ(以下、写真画像データと総称する)は写真画像処理部140へ入力される。

【0095】写真画像処理部140は、入力された写真画像データを網点画像再現方式(濃度パターン法)に従って変換する網点処理を行う。網点画像再現方式(濃度パターン法)は、電子写真方式のデジタル複写機やブリンタ等において写真画像を出力する方式として広く用いられており、入力画像データの1画素(入力画素)に対応する複数のサブビクセルの各々に対して予め濃度閾値が設定された網点パターン(スクリーンパターンともいう)を用い、入力画素を複数のサブビクセルに分割し、各サブビクセルの濃度値を、網点パターン上の対応するサブビクセルに設定された濃度閾値と比較し、比較結果に応じて各サブビクセルの濃度を「白」又は「黒」とすることで、入力画素の濃度を複数のサブビクセルによって表現するものである。

【0096】網点処理の一例として、入力画素の濃度が、50 い。但し本実施形態では、文字画像画像データに対する

22

256階調で表現され、入力画素を16個(=4×4)のサブピクセルに分割する態様において、入力画素の濃度値が「182」の場合の網点処理の結果(各サブピクセルのオン(黒:255)/オフ(白:0)の状態)の一例を図16に示す。写真画像処理部140には網点パターン出力部142が接続されており、写真画像処理部140は、入力された写真画像データに対し、網点パターン出力部142から入力された網点パターンに基づいてY、M、C、Bk各色のデータ毎に別々に網点処理を行う。

【0097】なお、本実施形態では、入力された画像デ ータをFS方向及びSS方向に各々2倍の解像度(FS 方向及びSS方向の解像度が1200dpi)の画像デ ータに変換し、該変換後の画像データを処理対象として レジずれの補正を行う。とのため、本実施形態では、と の解像度の変換と網点画像再現方式による変換を同時に 行うために、網点パターン出力部142からは1画素を 4個 (= 2×2) のサブピクセルに分割する網点パター ン (例えば図19に示すように、9画素(=3×3)の ブロックに対して解像度変換と網点画像再現方式による 変換を同時に行うための36個(=6×6)のサブピク セルから成る網点パターン)を出力し、写真画像処理部 140は入力された写真画像データに対し、複数画素の ブロックを単位として網点処理を行う。これにより、写 真画像処理部140に入力された写真画像データは、図 19に「多値出力値」として示すように、FS方向及び SS方向の解像度が1200dpiの画像データに変換 されて出力されることになる。

【0098】また、各色のデータに対して同一の網点バ ターンを用いて網点処理を行うと、僅かな位置ずれによ って色ムラが生じたり、各色の網点パターンが重なった 場合に生ずる縞模様(モアレ縞)の影響が大きくなる。 とのため、本実施形態ではスクリーン角θが互いに異な る4種類の網点パターンを各色のデータに対応させて用 いることで、モアレ縞の影響を軽減している。なお、ス クリーン印刷等の分野では、スクリーン角 θ としては0、15°、45°及び75°が好適であることが知ら れているが、本実施形態では、同一の網点パターンを繰 り返し使用してメモリ容量を削減するために、スクリー ン角 θ として有理正接で求まる値(スクリーン角 θ の演 算式 $\theta = tan^{-1}(Y/X)$ において、X、Yが共に整 数のときの値)を用いている。また、本実施形態では、 写真画像とグラフィックス画像に対し、スクリーンの線 数や角度等のパラメータが異なる網点パターンを用いて いる。

【0099】一方、文字画像はエッジの再現性等が重視され、階調性再現性よりも解像度が優先されるため、文字画像処理部138は、入力された文字画像データに対し、通常は上記の網点処理を含めて何ら処理を行わな

網点処理の実行をユーザが指示(設定)することで、文 字画像データに対して文字画像処理部138で網点処理 を行わせることも可能とされている。

【0100】文字画像処理部138から出力された文字 画像データ(FS方向及びSS方向の解像度が600d piの画像データ) は高解像度化演算部144に入力さ れる。600dpiの解像度で記録された画像上での画 素間隔は約42.3μmであるので、レジ補正のために 画素の記録位置を移動させる場合も、通常は約42.3 μm単位での移動となる。画素の記録位置を比較的大き 10 く移動させる場合 (所謂粗調整) にはこれで十分である が、画素の記録位置の僅かなずれ(例えば10μm以 下) も含めて補正するために、例えば10μm以下を単 位として画素の記録位置を移動させる場合(微調整)に は、単純な画像の座標位置変換(画素間隔を単位とする 画素の記録位置の移動)のみでは対応できない。

【0101】とのため、本実施形態では、FS方向及び SS方向の解像度が1200dpiの高解像度の画像デ ータへ変換し、高解像度の画像データ上でレジ補正のた めの画素位置の移動を行った後に、元の解像度(FS方 向及びSS方向の解像度が600dpi)の画像データ に戻す際に、600dpiの解像度での画素位置に対す る600dpiの解像度での画素間隔未満の画素位置の 偏倚(後述する処理領域内の濃度分布の偏倚)をコード 情報として記憶しておき、このコード情報に基づいて画 素の記録位置の微調整を行う。

【0102】高解像度化演算部144では、上記の処理 を実現するために、文字画像処理部138から出力され たFS方向及びSS方向の解像度が600dpiの文字 画像データを、FS方向及びSS方向の解像度が120 Odpiの画像データへ変換した後に、高解像度化演算 部144に接続された画素位置補正演算部146へ解像 度変換後の画像データを出力する。

【0103】解像度変換の方法としては種々の方法が知 られているが、例えばFS方向及びSS方向の解像度が 600dpiの画像データをFS方向及びSS方向の解 像度が1200dpiの画像データへ変換する場合、1 画素が4画素(=2×2)に分割されるため、個々の画 素の各色毎の濃度値が各々8ビットのデータで表されて いる場合、例として図17 (A) にも示すように、単一 の画素の濃度値(0~255の範囲内の値をとる)を4 (=2×2)で除し、得られた濃度値(0~64(=2 56/4)の範囲内の値をとる)を対応する4画素に各 々設定する方法を用いるととができる。との場合、元の 解像度の画像データへ戻す際には、個々の画素の濃度値 として、個々の画素に対応する4画素の濃度値の総和 (0~255の範囲内の値に戻る)を設定すればよい。

【0104】また、他の方法として、例として図17 (B) に示すように、単一の画素の濃度値を対応する複 24

定する方法を用いてもよい。この場合、元の解像度の画 像データへ戻す際には、個々の画素の濃度値として、個 々の画素に対応する複数画素の濃度値の平均値(0~2 55の範囲内の値をとる)を設定すればよい。

【0105】なお、写真画像処理部140から出力され た網点処理後の写真画像データについては、先にも説明 したように、既にFS方向及びSS方向の解像度が12 00dpiの画像データへ変換されているので、高解像 度化演算部144は、写真画像データに対しては上述し た解像度変換等の処理を何ら行うことなく、画素位置補 正演算部146へ出力する。

【0106】画素位置補正演算部146にはレジずれ補 正量演算部133が接続されており、レジずれ補正量演 算部133によって演算された各種のDCレジずれ補正 量 (詳しくは、色ずれ補正量、走査線傾き補正量、走査 線湾曲補正量、左側倍率補正量及び右側倍率補正量) と、FS方向及びSS方向のACレジずれの検知結果は 画素位置補正演算部146に入力される。

【0107】画素位置補正演算部146は、高解像度化 演算部144から入力されたFS方向及びSS方向の解 像度が1200dpiの画像データに対し、レジずれ補 正量演算部133から入力されたDCレジずれ補正量に 基づいて、レジずれのDC成分を補正するためのFS方 向に沿った画素位置の移動量及び移動方向、及びSS方 向に沿った画素位置の移動量及び移動方向を、各色の画 像データの各画素毎に演算する。

【0108】なお、レジずれのDC成分に対する補正 は、レジずれ補正量演算部133から入力された各種の DCレジずれ補正量(色ずれ補正量、走査線傾き補正 量、走查線湾曲補正量、左側倍率補正量、右側倍率補正 量) に従って、単に各色の画像データの各画素毎に位置 の移動量及び移動方向を演算すればよいが、レジずれの AC成分に対する補正については、画像データの各画素 が感光体20C、22C、24C、26Cの周面上の何 れの位置に記録されるかに応じて適正な補正量が相違す

【0109】とのため、画素位置補正演算部146は、 各感光体に取付けたロータリーエンコーダから出力され る信号に基づいて、感光体の周面上の何れの位置が走査 露光部による走査露光位置に対応しているかを常に監視 し、レジずれのAC成分に対する補正に際しては、上記 の監視結果に基づき、画像データ上の各画素が感光体の 周面上の何れの位置に記録されるのかを判定し、画像形 成位置のFS方向に沿った変動及びSS方向に沿った画 素間隔の変動の画像データ上での位相を判断する。

【0110】そして、レジずれのAC成分のうちFS方 向の補正を行うための画素位置の移動量及び移動方向 は、入力されたFS方向のACレジずれの検知結果、及 び画像形成位置のFS方向に沿った変動の画像データ上 数の画素(図では例として6画素(= 2×3))に各々設 50 での位相を判断した結果に基づいて、各画素のF S方向 に沿った位置に、画像形成位置のFS方向に沿った変動を打ち消す周期的な変化が生ずるように、画素位置の移動量及び移動方向(FS方向の+方向又は-方向)を各画素毎に演算するととによって行う。

25

【0111】また、レジずれのAC成分のうちSS方向の補正を行うための画素位置の移動量及び移動方向は、入力されたFS方向のACレジずれの検知結果、及びSS方向に沿った画素間隔の変動の画像データ上での位相を判断した結果に基づいて、SS方向に沿った画素間隔に、SS方向に沿った画素間隔の変動を打ち消す周期的10な変化が生ずるように、画素位置の移動量及び移動方向(SS方向の+方向又は一方向)を各画素毎に演算することによって行う。このように、画素位置補正演算部146は本発明の演算手段としての機能の一部も備えている。

【0112】また後述するように、レジずれ補正量演算部133によるDCレジずれ補正量の演算及びFS方向及びSS方向のACレジずれの検知は、シェブロンパターン132を繰り返し形成しながら順に行われる。また、レジずれのAC成分に対する補正は、前述のように 20感光体の周面上での記録位置に応じて各画素に対する補正量が相違する。

【0113】とのため、画素位置補正演算部146は、 ACレジずれ補正量が入力された場合には、入力された ACレジずれ補正量そのものを記憶すると共に、DCレ ジずれ補正量が入力された場合には、入力されたDCレ ジずれ補正量から求めた各色の画像データの各画素毎に 移動量及び移動方向を記憶する。そして、入力された画 像データに対するレジずれの補正に際しては、まず前述 のように、レジずれのAC成分を補正するための各画素 の位置の移動量及び移動方向を演算し、演算結果を、D Cレジずれ補正量から求めた各色の画像データの各画素 の位置の移動量及び移動方向に加算することで、レジず れを補正するための各画素の位置の最終的な移動量及び 移動方向を求める。また、新たなDCレジずれ補正量が 入力された場合には、記憶しているDCレジずれ補正量 から求めた画素位置の移動量及び移動方向を、新たに入 力されたDCレジずれ補正量に応じて修正して更新す

【0114】なお、以降の処理の説明では、説明を簡単 40 にするためにY、M、C、B k 各色を区別しないが、以降は各色の画像データに対して各々同一の処理が行われる。

【0115】続いて、画素位置補正演算部146は、レジずれを補正するための各画素の位置の移動量及び移動方向に応じて、高解像度化演算部144から入力された画像データ(FS方向及びSS方向の解像度が1200dpiの画像データ)の各画素の位置を移動させる(詳しくは移動後の座標値を演算する)。なお、移動前の画素の座標を(x,y)、移動後の画素の座標を(x.。

y*)、x方向(FS方向)の移動量及び移動方向をtranslation、y方向(SS方向)の移動量及び移動方向をtranslation、とすると、移動後の座標は例えば下記の演算式を用いて演算することができる。

[0116]

【数6】

$$\begin{bmatrix} x & * \\ y & * \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} translation_x \\ translation_y \end{bmatrix}$$

【0117】なお、上記の演算式を用いて各画素の位置を移動させた場合、画素位置移動後の画像における各画素が、画素位置移動前の画像における何れの画素に対応しているかについては、下記の演算式を用いて画素位置移動前の座標(x,y)を求めることで行うことができる。

[0118]

【数7】

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x * \\ y * \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} translation_x \\ translation_y \end{bmatrix}$$

【0119】ところで、上記のように、レジずれを補正するための移動量及び移動方向に応じて各画素の位置を移動させた場合、移動後の各画素の位置は、FS方向及びSS方向の解像度が1200dpiの画像データにおける正規の画素位置(格子点位置)から外れていることが殆どである(すなわち、格子点の座標(x,y)のx及びyが各々整数で表されるとすると、移動後の画素の座標(x*、y*)のx*及びy*は殆どの場合、小数点以下の値を含む数値となる)。

[0120] とのため、画素位置補正演算部146は画素位置の移動を行った後に、画素位置移動後の各画素のデータに基づいて、解像度が1200dpiの画像データ上の各格子点位置における濃度値を演算する処理(本実施形態ではこの処理を画素位置の整数化と称する)を行う。

[0121] 画素位置の整数化方法としては種々の方法を適用可能であり、高速処理に適した整数化手法としては、ゼロ次ホールド法やニアレストネイバー法等が挙げられる。ゼロ次ホールド法は、出力画素(x,y)の画素値(濃度値)として、その直前の入力画素の画素値を設定するアルゴリズムであり、図20(A)に示す例では、入力画素([x],[y])が与えられた時点で、出力画素(x,y)の画素値として入力画素([x],[y])の画素値を設定している。この方法では画素位置の比較のみで画素値を演算する必要がなく、非常に高速に処理を行うことができる。但し、整数化による画質劣化の度合いが比較的大きいという欠点がある。

【0122】また、ニアレストネイバー法は、出力画素 (x,y)の画素値として最近傍の入力画素の画素値を 50 設定するアルゴリズムである。図20(B)に示す例で

は、下図においては出力画素(x,y)と、それを囲む入力画素([x],[y])([x]+1,[y])([x],[y] +1)([x]+1,[y]+1)の座標が比較され、最も近い入力画素(下図では入力画素([x],[y]+1)の画素値が出力画素(x,y)の画素値として設定される。この方法では、ゼロ次ホールド法よりも座標の比較回数が多くなるが、画素値を演算する必要がないので、ゼロ次ホールド法と同様に高速に処理を行うことができる。但し、整数化により抜けが発生したり、画像の滑らかさが失われるなど、画質劣化の度合いも比較的大きい。

27

【0123】また、画質、処理速度ともに標準的な整数化のアルゴリズムとしては、4点補間法(Bi-Linear)等が挙げられる。4点補間法は出力画素(x. y)の画素値を、その周囲に存在する4個の入力画素([x], [y])([x]+1, [y])([x], [y]+1)([x]+1. [y]+1)の画素値から補間演算によって求めるアルゴリズムである。図20(C)に示すように、例えば入力画素([x], [y])に対する出力画素のx, y座標値の差分p, qに従い、

density(x,y) = $(1-q) \cdot [(1-p) \cdot density([x],[y]) + p \cdot den 20$ sity([x]+1,[y])} +q \{ $(1-p) \cdot density([x],[y]+1) + p$ \density([x]+1,[y]+1)}

なる演算を行うことで出力画素(x,y)の画素値を求める。4点補間法は演算量もそれ程多くはなく、画質も比較的良好である。しかし、細線が消えたり多少ぼけた画線になる等のように、多少の画質の劣化が発生する場合もある。

【0124】画質の劣化が少ない整数化のアルゴリズム としては、投影法や16点補間法、輸理演算法等が挙げ られる。投影法は画素を点ではなく面として捉え、出力 30 画素を複数の入力画素の面積比率で決定するアルゴリズ*

density $(x, y) = [f(y_1) f(y_2) f(y_3) f(y_4)]$.

* ムである。図2 1 (A) において実線は5×4画素から成る入力画素の境界を表し、破線は3×3画素から成る出力画素の境界を表している。図2 1 (A) において濃度を変えて示す出力画素(x,y)(入力画素([x],[y])([x]+1,[y])([x],[y]+1)([x]+1,[y])([x],[y]+1)([x]+1,[y]+1)に跨っている画素)の画素値を投影法によって決定する場合を説明すると、図6(B)に示すように、出力画素(x,y)のうち、入力画素([x],[y])([x]+1,[y])([x]+1,[y])([x]+1,[y]+1)([x]+1,[y]+1)と重なっている部分の面積比は、各々2/9,1/9,4/9,2/9であるので、

density(x,y)=2/9·([x],[y])+1/9·([x]+1,[y])+4/9·([x],[y]+1)+2/9·([x]+1,[y]+1)

なる演算を行うことで出力画素 (x, y)の画素値を求める。投影法は面積比を求める等の演算量が多く、処理に多少時間がかかるものの画質の劣化は小さく、特に写真等の絵柄部分に有効である。その反面、文字や線画では多少エッジがぼけることがある。

【0125】また16点補間法(Cubic Spline)は、出力画素の画素値を周囲16個の入力画素の画素値から補間演算によって求めるアルゴリズムである。図22及び以下の演算式に示すように、16点補間法は、出力画素(x,y)の周囲の16個の入力画素値と、これらの入力画素のx,y座標値と出力画素のx,y座標値と出力画素のx,y座標値との差であるx1~x4及びy1~y4を用いて出力画素(x,y)の画素値を求めるものである。16点補間法は処理にかなりの時間がかかるものの、整数化による画

[0126]

質劣化の度合いが最も小さい。

【数8】

 $f(t) = \sin(\pi t) / (\pi t)$

【0127】画素位置補正演算部146による画素位置の整数化は、上述した各種の整数化方法のうちの何れか1つ(例えば4点補間法)を固定的に用いてもよいし、各種の整数化方法の特性を勘案し、画像データの種類(文字画像データか写真画像データか)に応じて選択的に用いるようにしてもよい。上述した画素位置の整数化を行うことにより、例として図18に示す「レジずれ補正後の文字画像データ」或いは図19に示す「レジずれ補正後の写真画像データ」のように、FS方向及びSS方向の解像度が1200dpiでかつレジずれが補正さ

れた画像データが得られることになる。

【0128】なお、上記の画素位置の整数化により、画像(特に画像中のエッジ部分)にぼけが発生することがある。このような場合には、画素位置補正演算部146において、エッジ強調処理を行うことが望ましい。フィルタ演算によってエッジ強調を行う場合のエッジ強調フィルタの一例を下記に示す。

[0129]

【数9】

$$W=C\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$D(i, j) = C \begin{cases} a_{11}g(i-1, j-1) + a_{12}g(i, j-1) + a_{13}g(i+1, j-1) \\ + a_{21}g(i-1, j) + a_{22}g(i, j) + a_{23}g(i+1, j) \\ + a_{31}g(i-1, j+1) + a_{32}g(i, j+1) + a_{33}g(i+1, j+1) \end{cases}$$

【0130】上記の演算式において、i及びjは画素位置を表す整数値、g(i,j)は画素(i,j)の画素値(濃度値)、D(i,j)はフィルタリング後の画素値(i,j)の画素値、Cは重み係数である。上記の演算式は、画素(i,j)を中心とする3×3画素の領域内の9個の画素の画素値を用いて、画素(i,j)の画素値を演算する演算式である。ここでは3×3画素の領域に代えて、5×5画素等の他のサイズの領域を用いてもよい。

79

【0131】上述した処理を経た画像データ(FS方向 及びSS方向の解像度が1200dpiでかつレジずれ が補正された画像データ)は、画素位置補正演算部14 6から低解像度化演算部148へ入力される。

【0132】低解像度化演算部148では、高解像度化 演算部144についての説明に併記したように、入力さ れた画像データのFS方向及びSS方向の解像度を12 00dpiから600dpiへ低下させる低解像度化処 理を行うが、この低解像度化処理に先立って低解像度化 演算部148は濃度分布判定処理を行う。

【0133】この濃度分布判定処理は、低解像度化処理前の高解像度画像データに対し、複数画素から成る処理領域(低解像化処理後の画像データにおける1画素に相当する領域:すなわち4(=2×2)画素から成る領域)を単位として、処理領域内の高濃度の部分が処理領域内の何れの位置に位置しているのかを判定する処理である。

【0134】低解像度化処理では、個々の画素の濃度値として、個々の処理領域内の各画素の濃度値の総和又は平均を、個々の処理領域に対応する1画素の濃度値とし、通常の走査露光処理では、個々の画素の濃度値を表すドットを個々の画素の中心付近に記録する。この処理では、処理領域内の各画素の濃度が同一又は接近していた場合には問題ないものの、処理領域内の濃度分布が偏倚していたとしても画素の中心付近に記録するので、低解像度化前の処理領域内における濃度分布の偏倚は記録 画像に反映されない。従って、低解像度化前の処理領域内における濃度分布の偏倚は記録内における濃度分布の偏倚は、低解像度化及び走査露光の段階で画像から情報として欠落することになり、画質の劣化が生ずる。

【0135】低解像度化演算部148は、低解像度化前の処理領域内における濃度分布の偏倚を、画像記録時に個々の画素の記録位置を微調整することで表現するために、前述の濃度分布判定処理を行う。具体的には、例え

ば処理領域内の各画素の濃度を比較し、処理領域内の最低濃度の画素との濃度偏差が所定値以上の画素、及び濃度値が関値以上の画素を高濃度部と判定し(この所定値及び関値はユーザが変更設定可能としてもよい)、高濃度部と判定した画素の位置を低解像度化演算部148に接続されたコード情報設定部150へ出力することを、低解像度化前の高解像度画像データ上の全ての処理領域に対して順次行う。

【0136】図18及び図19には濃度分布判定結果の一例を示す。なお、この判定結果は高濃度部と判定した画素を「1」、高濃度部と判定されなかった画素を「0」で表記して示している。

20 【0137】なお、低解像度化前の処理領域内における 濃度分布の偏倚を記録画像に反映させることは、エッジ 部分の再現性が重視される文字画像において特に重要で あるので、エッジ部分の再現性よりも階調の再現性が重 視される写真画像の画像データに対して濃度分布判定処 理を行う場合には、処理領域内における濃度分布が極端 に偏倚していた場合にのみ濃度分布の偏倚が検知される ように、文字画像データに対して濃度分布判定処理を行 う場合よりも前述の所定値や閾値を大きな値としてもよ いし、写真画像データに対しては濃度分布判定処理を行 30 わないようにしてもよい。

【0138】また、高濃度部の判定方法についても上記に限定されるものではなく、例えば処理領域内の各画素の濃度の平均値を演算し、この平均値を関値とし、濃度値が平均値よりも高い画素を高濃度部に相当する画素と判定するようにしてもよい。更に、処理領域として、16(=4×4)画素から成る領域等のように、上記と異なるサイズの領域を適用してもよい。

[0139]コード情報設定部150では、低解像度化演算部148から順次入力される各処理領域に対する濃度分布判定処理の結果(高濃度部と判定された画素位置の判定結果)に基づいて、各処理領域に対し、高濃度部の有無及び位置を表すコード情報を各々設定する。一例として、4(=2×2)画素から成る処理領域における高濃度部のバターン、及び各バターンに対して設定されるコード情報の一例を図23に各々示す(図18及び図19も参照)。このコード情報は、高濃度部のバターン(濃度分布の偏倚)を表す情報であり、このコード情報に基づいて個々のドットの記録位置が微調整されるので、本発明に係る「画素間隔未満の微調整量」に対応し

ている。

【0140】低解像度化演算部148では、上記の濃度 分布判定処理を行った後に先に説明した低解像度化処理 を行う。これにより、例として図18及び図19に示す ように、FS方向及びSS方向の解像度が600dpi の出力画像データが得られる。この低解像度化処理は、 画素位置補正演算部146で行われる処理、上述した濃 度分布判定処理、及びコード情報設定部150における コード情報の設定と共に、本発明における「演算手段に よって演算されたレジ補正量を、画像データ上の個々の 10 画素毎の値に対する修正量と、個々の画素の記録位置に 対する画素間隔未満の微調整量と、に分解し、修正量に 応じて画像データを修正する」処理に対応しており、画 素位置補正演算部146、低解像度化演算部148及び コード情報設定部150は本発明の修正手段に対応して

31

【0141】低解像度化演算部148における低解像度 化処理によって得られた出力画像データは合成部152 によって入力される。合成部152は、単一のページに 対応する画像データがオブジェクトタグによって文字画 20 像データと写真画像データに分離されて別々に処理され た場合に、これらを単一のページの画像データとして合 成する合成処理を行う。なお、この合成処理では一部の 画素に重なりが生ずる場合もあるが、その場合には、重 なりが生じた画素の濃度値として濃度が高い方の画素の 濃度値を設定する。

【0142】合成部152にはD/A変換器154が接 続されており、開始位置検出センサ78から出力される 開始位置信号SOSが表す変調開始タイミング(レーザビ ームの各回の主走査における変調開始タイミング)よ り、図示しないクロック信号発生装置から出力された画 素クロック信号(FS方向に沿った各画素の記録周期 (記録期間)を規定する信号) に同期したタイミング で、1回の主走査で露光記録すべき画素列のデータをD /A変換器154へ順に出力する。

【0143】D/A変換器154の信号出力端は3個の 比較器 1 5 6 A, 1 5 6 B, 1 5 6 C の 2 個の信号入力 端の一方に各々接続されており、D/A変換器154に 入力された各画素のデータは、各画素の濃度値に応じた 電圧レベルのアナログの画像信号(詳しくは濃度値が高 40 くなるに従って電圧レベルが低くなる信号:図24参 照) に変換されて比較器156A, 156B, 156C に各々入力される。

【0144】また本実施形態では、画素クロック信号と 周期が等しくかつ互いに異なる波形の三角波信号を生成 する3個の三角波信号生成回路158A, 158B, 1 58Cが設けられている。三角波信号生成回路158A から出力される三角波信号の波形は、図24(A)にも 示すように、或る画素の記録期間が始まるタイミングで 一定の電圧レベル迄瞬時に立ち上がり、その後、前記画 50 【0149】また、図24(B)に示すように、比較器

素の記録期間が終わるタイミングで電圧レベルが0に戻 るように一定の傾きで緩やかに電圧レベルが低下すると とが繰り返される波形である。三角波信号生成回路15 8 Aの信号出力端は比較器 1 5 6 Aの信号入力端の他方 に接続されている。

【0145】また、三角波信号生成回路158Bから出 力される三角波信号の波形は、図24(B)にも示すよ うに、或る画素の記録期間が始まるタイミングで一定の 電圧レベルになっており、前記画素の記録期間の中央に 相当するタイミングで電圧レベルが0 になるように前記 画素の記録期間が始まるタイミングより一定の傾きで電 圧レベルが低下し、その後、前記画素の記録期間が終わ るタイミングで電圧レベルが前記一定の電圧レベルに戻 るように、前記中央に相当するタイミングより一定の傾 きで電圧レベルが上昇することが繰り返される波形であ る。三角波信号生成回路158Bの信号出力端は比較器 156Bの信号入力端の他方に接続されている。

【0146】また、三角波信号生成回路158℃から出 力される三角波信号の波形は、図24(C)にも示すよ うに、或る画素の記録期間が終わるタイミングで前記一 定の電圧レベルに達するように一定の傾きで緩やかに電 圧レベルが上昇し、前記画素の記録期間が終わるタイミ ングで瞬時に電圧レベルが0に戻ることが繰り返される 波形である。三角波信号生成回路158Cの信号出力端 は比較器156Cの信号入力端の他方に接続されてい

【0147】比較器156A, 156B, 156Cは、 D/A変換器154から入力された画像信号の電圧レベ ルを、入力された三角波信号の電圧レベルと比較し、画 像信号の電圧レベルが三角波信号の電圧レベル以上のと きにはハイレベル、画像信号の電圧レベルが三角波信号 の電圧レベル未満のときにはローレベルとなるPWM (バルス幅変調信号)を出力する。比較器 1 5 6 A, 1 56B、156Cには同一の画像信号が入力されるが、 比較器156A, 156B, 156Cに入力される三角 波信号の波形は互いに異なっている。

【0148】このため、図24(A)に示すように、比 較器156Aから出力されるPWM信号は、入力された 画像信号が最大濃度に対応する電圧レベル(との場合は 常にハイレベルになる)及び最小濃度に対応する電圧レ ベル(この場合は常にローレベルになる)以外の場合に は、ハイレベルとなっている期間が各画素の記録期間内 のうちの後側に偏倚している波形となる。とのPWM信 号に応じてLD70の点消灯を制御(PWM信号がハイ レベルとなっている期間に点灯) したとすると、図24 (A) に「LDの点灯期間」として示すように、LDが 点灯することによって感光体上に形成されるドットは、 その記録位置がFS方向下流側(便宜的に右側という) に寄ることになる(以下、これを右寄せという)。

156Bから出力されるPWM信号は、入力された画像 信号が最大濃度に対応する電圧レベル及び最小濃度に対 応する電圧レベル以外の場合には、ハイレベルとなって いる期間が各画素の記録期間内の中央に位置している波 形となる。とのPWM信号に応じてLD70の点消灯を 制御したとすると、図24(A)に「LDの点灯期間」 として示すように、LDが点灯することによって感光体 上に形成されるドットは、その記録位置が、記録期間内 にレーザビームが走査する範囲の中央に位置することに なる(以下、これを中寄せという)。

【0150】また、図24 (C) に示すように、比較器 156Cから出力されるPWM信号は、入力された画像 信号が最大濃度に対応する電圧レベル及び最小濃度に対 応する電圧レベル以外の場合には、ハイレベルとなって いる期間が各画素の記録期間内のうちの前側に偏倚して いる波形となる。とのPWM信号に応じてLD70の点 消灯を制御したとすると、図24(C)に「LDの点灯 期間」として示すように、LDが点灯することによって 感光体上に形成されるドットは、その記録位置がFS方 向上流側(便宜的に左側という)に寄ることになる(以 20 下、これを左寄せという)。

【0151】比較器156A, 156B, 156Cの信 号出力端はセレクタ160の信号入力端に各々接続され ており、比較器156A, 156B, 156Cから出力 される右寄せ、中寄せ、左寄せの3種類のPWM信号は セレクタ160に各々入力される。セレクタ160はコ ード情報設定部150に接続されており、各画素に対応 するPWM信号がセレクタ160に順に入力されるのと 同期したタイミングで、各画素に対応するコード情報が セレクタ160に順に入力される。

【0152】セレクタ160は入力されたコード情報 が、対応する画素の低解像度化前のFS方向についての 濃度分布が右側に偏倚していることを表す値(例えば図 23において「FS右」と記された値) である場合には 右寄せのPWM信号を選択・出力し、対応する画素の低 解像度化前のF S方向についての濃度分布が左側に偏倚 していることを表す値 (例えば図23において「FS 左」と記された値)である場合には左寄せのPWM信号 を選択・出力し、対応する画素の低解像度化前のFS方 向についての濃度分布が右側にも左側にも偏倚していな いことを表す値(例えば図23において「FS無し」又 は「FS中」と記された値)である場合には中寄せのP WM信号を選択・出力することを、画素クロック信号に 同期したタイミングで各画素毎に行う。

【0153】セレクタ160の出力端は強度変調部16 4に接続されており、強度変調部164からは、セレク タ160から入力されたPWM信号がハイレベルとなっ ている期間にのみLD70を点灯させるPWAM信号が 出力され、このPWAM信号に応じてLD70の点消灯 が制御されるので、レーザビームの走査露光によって感 50 表すコード情報に基づき、光量が通常光量に対して所定

光体の周面上に形成される画像(静電潜像)は、各画素 の濃度値に応じた時間だけレーザビームが照射されると とで各画素に対応するドットが記録されると共に、各画 素の低解像度化前のFS方向についての濃度分布に応じ て、各ドットの記録位置がFS方向に筬調整されること

【0154】また、コード情報設定部150には光量制 御部162に接続されており、各画素に対応するPWM 信号に応じてLD70が点消灯されるのと同期したタイ 10 ミングで、各画素に対応するコード情報が光量制御部1 62に順に入力される。光量制御部162はLD70に 供給する電流値を制御することでLD70から射出され るレーザビームの光量を通常光量に制御すると共に、入 力されたコード情報が、対応する画素の低解像度化前の SS方向についての濃度分布がSS方向上流側(便宜的 に上側という) に偏倚していることを表す値(例えば図 23において「FS上」と記された値)、又は前記濃度 分布がSS方向下流側(便宜的に下側という)に偏倚し ていることを表す値(例えば図23において「FS下」 と記された値)であった場合には、LD70から射出さ れるレーザビームの光量が通常の光量よりも所定量低下 するように、LD70に供給する電流値を制御する光量 制御信号を出力する。

【0155】光量制御部162の信号出力端は強度変調 部164の信号入力端に接続されており、強度変調部1 64からは、LD70を点灯させる期間内にLD70に 供給する電流が、光量制御部162から入力された光量 制御信号に応じた大きさとなるように制御するPWAM 信号が出力され、このPWAM信号に応じてLD70に 供給する電流値が制御される。

【0156】例として、低解像度化前の処理領域内の濃 度分布がSS方向上流側(上側という)に偏倚していた 場合(上側に高濃度部が存在していた場合)、対応する 画素には濃度分布が上側に偏倚していることを表すコー ド情報が付加されるが、画像上でとのような画素の上側 に位置する画素は、低解像度化前の処理領域内の少なく ともSS方向下流側(下側という)には高濃度部が存在 していることが殆どであり、前記処理領域内の全画素が 髙濃度部であることも多い。

【0157】例として図25 (B) には、濃度分布が上 側に偏倚していることを表すコード情報が付加された画 素列(9(= 3 × 3)画素のマトリクスにおけるSS方 向に沿って3列目の各画素)に対し、画像上で上側に位 置している画素列(2列目(及び1列目)の各画素) が、低解像度化前の処理領域内の全画素が高濃度の画素 であり、この濃度分布を表すコード情報に基づき通常光 **量に制御されたレーザビームによって1列目及び2列目** の画素列に相当する領域が露光され、3列目の画素列に 相当する領域が、濃度分布が上側に偏倚していることを

量低下するように制御されたレーザビームによって露光 された場合を示す。

【0158】上記のように、3列目の画素列に相当する領域を通常光量よりも所定量低い光量のレーザピームによって露光することにより、図25(B)を、3列目の画素列に相当する領域がレーザピームによって露光されなかった場合を示す図25(A)と比較しても明らかなように、各回の走査によって感光体に照射されるレーザピームの合成露光エネルギーは、SS方向に沿ったエネルギー分布の幅が下側(3列目の画素列に相当する領域)側へ広がることになる。

【0159】感光体上には、レーザビームの合成露光エネルギーに対応する電位分布の静電潜像が形成され、現像関値以下の電位の領域に現像器によってトナーが付着されるので、図25(B)のマトリクスにも示されているように、3列目の画素列に相当する領域では、トナーが付着されてドットとして形成される部分が上側に寄ることになる(以下、これを上寄せという)。

【0160】また、濃度分布が下側に偏倚していることを示すコード情報が付加された画素に対し、画像上で下 20側に位置している画素は、低解像度化前の処理領域内の少なくとも上側には高濃度部が存在していることが殆どであり、前記処理領域内の全画素が高濃度部であることも多い。従って、濃度分布が下側に偏倚していることを示すコード情報が付加された画素を、通常光量よりも所定量低い光量のレーザビームによって露光した場合には、上記と同様に、トナーが付着されてドットとして形成される部分が下側に寄ることになる(以下、これを下寄せという)。

【0161】これにより、レーザビームの走査露光によって感光体の周面上に形成される静電潜像を現像することによって得られる画像(トナー像)は、各画素に対応するドット記録位置が、各画素の低解像度化前のSS方向についての濃度分布に応じてSS方向に微調整されることになる。このように、D/A変換器154、比較器156A,156B,156C、三角波信号生成回路158A,158B,158C、セレクタ160、光量制御部162及び強度変調部164は、本発明の制御手段に対応している。

【0162】例として図26に示すように、画素の境界を斜めに横切る理想ライン(例えば文字を構成するラインの一部)を記録する場合、従来のように、個々の画素の濃度値を文字部分に相当する値(例えば255)か、又は下地部分に相当する値(例えば0)にする2値展開を行って画像として記録した場合、前記ラインは記録画像上で理想ラインとは大きく異なる段付きの折れ線として記録される。

【0163】とれに対し、本実施形態では、各画素の濃 算部133はSS方向の色ずれ量を検知して補正量を演 度値が、低解像度化前の処理領域内の各画素の濃度値に 算し、画素位置補正演算部146は、前回の補正時に用 応じて中間的な値をとり得る(図26ではこれを「多値 50 いた画素位置の移動量及び移動方向を、今回新たに演算

展開」と称し、濃度値が中間的な値となっている画素の 濃度値を各画素と対応させて百分率で示している)と共 に、低解像度化前の処理領域内の濃度分布の偏倚に応じ てコード情報が設定され、露光時には、各画素の濃度値 に応じてPWM変調によってレーザビームの点灯時間が 制御されると共に、FS方向及びSS方向に画素位置が 微調整されるので、図26に示されているように、前記 ラインは記録画像上で理想ラインに近い外形形状と視認 されるように記録されることになる。

【0164】次に本実施形態におけるレジ補正の手順について説明する。本実施形態では、レジずれのDC成分の粗調整(倍率変化に関しては粗調整は行わない)、レジずれのAC成分の調整、レジずれのDC成分の微調整、の順序でレジ補正を行う。なお、レジ補正を行っている間は、シェブロンパターン132を形成するための画像データがレジ補正部130に入力され、レジ補正部130から出力された画像データ及びコード情報に応じて変調されると共に光量が制御されたレーザビームにより、画像形成部20、22、24、26によって中間転写ベルト30上にシェブロンパターン132が形成されて

【0165】レジずれのDC成分の粗調整は以下のようにして行われる。すなわち、中間転写ベルト30上に形成されたシェブロンパターン132がパターン検出部28によって検出されることでレジ補正部130にパターン検知信号が入力されると、レジずれ補正量演算部133はまず走査線傾き量を検知し、走査線傾き補正量を演算する。画素位置補正演算部146は、演算された走査線傾き補正量に基づき、シェブロンパターン132の画像データに対して走査線傾きの補正を行う。

【0166】走査線傾きが補正されたシェブロンパターン132が中間転写ベルト30上に形成され、該シェブロンパターン132がパターン検出部28によって検出されるととでレジ補正部130にパターン検知信号が入力されると、続いて、レジずれ補正量演算部133は走査線湾曲量を検知して補正量を演算し、画素位置補正演算部146は、前回の補正時に演算した画素位置の移動量及び移動方向を、今回新たに演算された走査線湾曲の補正量に応じて修正し、修正後の画素位置の移動量及び移動方向に基づいてシェブロンパターン132の画像データを補正することで、該画像データに対して走査線傾き及び走査線湾曲を各々補正する。

【0167】走査線傾き及び走査線湾曲が補正されたシェブロンパターン132が中間転写ベルト30上に形成され、該シェブロンパターン132がパターン検出部28によって検出されることでレジ補正部130にパターン検知信号が入力されると、続いて、レジずれ補正量演算部133はSS方向の色ずれ量を検知して補正量を演算し、画素位置補正演算部146は、前回の補正時に用いた画素位置の移動量及び移動方向を、今回新たに演算

された補正量に応じて修正して用いることで、シェブロ ンパターン132の画像データに対して走査線傾き、走 査線湾曲及びSS方向の色ずれを各々補正する。

37

【0168】走査線傾き、走査線湾曲及びSS方向の色 ずれが補正されたシェブロンパターン132が中間転写 ベルト30上に形成され、該シェブロンパターン132 がパターン検出部28によって検出されることでレジ補 正部130にパターン検知信号が入力されると、続い て、レジずれ補正量演算部133はFS方向の色ずれ量 を検知して補正量を演算し、画素位置補正演算部146 10 は、前回の補正時に用いた画素位置の移動量及び移動方 向を、今回新たに演算された補正量に応じて修正して用 いるととで、シェブロンパターン132の画像データに 対して走査線傾き、走査線湾曲、SS方向及びFS方向 の色ずれを各々補正する。

【0169】上記のようにして、レジずれのDC成分に ついての粗調整を行うことで、レジずれのDC成分は僅 かに残留するのみとなる。この後にレジずれのAC成分 についての補正を行うことで、レジずれのAC成分を精 度良く補正できる補正量を得ることができ、続いて全体 20 倍率変化及び左右倍率変化を含むレジずれのDC成分の 微調整を行うことで、レジずれのAC成分の影響が非常 に小さくされ、レジずれのDC成分を高精度に補正でき る補正量を得ることができる。

【0170】なお、倍率変化の補正は以下のようにして 行ってもよい。すなわち、例として図27に示すよう に、画像をh個(図27ではh=4)のエリアに分割 し、h個の分割エリア毎に倍率変化を検出し、画像処理 によって倍率変化を補正した後に統合する。エリアの分 割数hは可変としてもよい。エリアの分割数hの値を大*30

> エリア1 エリア2 95% 検出倍率 予測倍率 95% 95+(98-95)/4 補正倍率 100/95 100/(95+(98-95)/4)

なお、FS方向の倍率変化、及び補正倍率についても上 記と同様に扱うことができる。

【0175】また、上記のように画像を複数のエリアに 分割し、各エリア毎に倍率変化の補正を行った場合、互 いに異なる補正倍率が設定された複数のエリアに跨って いる文字に、補正後の画像上で歪みが生ずる恐れがあ る。これを回避するためには、例えばパターンマッチン グや文字タグ等によって文字か否かの認識を行い、複数 のエリアに跨っている文字については、それぞれのエリ アと重なっている部分の面積比に応じて、文字全体を何 れか1つのエリアに帰属させ、帰属させたエリアに設定 されている補正倍率で倍率変化の補正を行うようにすれ ばよい。

【0176】また、上記ではドットの記録位置を、FS 方向について右寄せ、中寄せ、左寄せの3段階、88方 向についても上寄せ、中寄せ、下寄せの3段階に微調整 50 が、何れか一方の方向(例えば色ずれが顕著に視認され

* きくすることにより、より小さなエリアを単位として画 像の倍率変化を補正することができる。また、倍率変化 をFS方向及びSS方向について別個に検知し、FS方 向及びSS方向について独立に倍率変化を補正してもよ い。これは次の演算式を用いることで実現できる。

[0171]

【数10】

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} scaling_x & 0 \\ 0 & scaling_y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

【0172】上記の演算式において、scalingはx方向 (FS方向)の倍率係数、scalingはy方向(SS方 向)の倍率係数、(x,y)は移動前の画素の座標、 (x*, y*)は移動後の画素の座標である。

【0173】なお、画像を複数個のエリアに分割した場 合、センサ配置の制約等の理由により全てのエリアにつ いて倍率変化をセンサによって検出できない場合も生じ 得るが、このような場合には、隣接するエリアの倍率変 化の検出結果から補間演算によって求めればよい。一例 として、画像をFS方向に沿って4個のエリア1~4に 分割し、副走査方向の倍率変化を検出して補正する際 に、FS方向の中間部に位置しているエリア2及びエリ ア3については、センサによって倍率変化を検出できな い場合を想定し、本来の倍率を100%、エリア1の検 出倍率が95%、エリア4の検出倍率が98%であった とすると、エリア2及びエリア3の倍率変化は下記のよ うに補間演算によって求めることができ、それぞれのエ リアの補正倍率を求めることができる。

[0174]

エリア3 エリア4 98% 95+(98-95)/2 98% 100/(95+(98-95)/2) 100/98

する場合を説明したが、これに限定されるものではな く、より細かく微調整するように構成することも可能で ある。例えばSS方向については、画素の記録期間内に おいて電圧レベルがOとなるタイミングが異なるn種類 (n≥4)の三角波を選択的に用いることで実現でき 40 る。また、例えばSS方向については、レーザビームの 光量を複数段階に変化させて合成露光エネルギーのSS 方向に沿った分布を各々求め、このエネルギー分布、感 光体の表面電位及び現像閾値に基づいて、レーザビーム の光量とドットの記録位置の移動量との関係を予め求め ておき、低解像度化前の処理領域内の濃度分布のSS方 向に沿った偏倚度合いに応じて、レーザビームの光量を 制御することで実現できる。

【0177】更に、上記では画素の記録位置の微調整を FS方向及びSS方向について各々行う場合を説明した

る方向) についてのみ、画素の記録位置を行うようにし てもよい。これにより、本発明に係る画像形成装置の構 成をより簡単にすることができる。 請求項1の発明はこ のような態様も権利範囲に含むものである。

【0178】また、記録材料の両面に一定サイズの画像 を形成する態様においては、一方の面に画像を形成する ことで記録材料のサイズが変化する (詳しくは記録材料 に熱を加える定着処理を行うことで変化する)ので、記 録材料のサイズと該記録材料に形成した画像のサイズの 比が変動することで、記録材料の各面に形成した画像の 10 サイズが不揃いとなる。本発明は、上記の態様におい て、各面に形成する画像のサイズが一定となるように補 正する場合にも適用可能である。

【0179】また、上記ではSOS、COS、EOSに 相当する3箇所にバターン検出ユニット90A.90 B. 90Cを設け、パターン検出ユニットに対応する箇 所にバターンを形成してレジずれを検知する場合を説明 したが、これに限定されるものではなく、より多数のパ ターン検出ユニットを設けてレジずれを検出するように してもよい。この場合、上記の実施形態では直線で近似 20 していた走査線湾曲を、多数のパターン検出ユニットに よる検出結果に基づいて、より実際の走査線湾曲に近い 関数(例えば屈曲歪み関数等)で近似することが可能と なる。

【0180】更に、本発明は上記で説明した実施形態に 限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した技 術的事項の範囲内において、種々の変更が可能であるこ とを付記しておく。

[0181]

7記載の発明は、複数の画像のレジずれを補正するため のレジ補正量を複数の画像の各部分毎に演算し、演算し たレジ補正量を、画像データ上の個々の画素毎の値に対 する修正量と、個々の画素の記録位置に対する画素間隔 未満の微調整量と、に分解し、修正量に応じて画像デー タを修正し、複数の画像の形成が、修正した画像データ を用いて行われ、かつ微調整量に従って個々の画素の記 録位置が微調整されるように制御するので、装置コスト の大幅な増大を招くことなくレジずれを高精度に補正す ることができる、という優れた効果を有する。

【0182】請求項2記載の発明は、請求項1記載の発 明において、画像形成手段による画像形成における主走 査方向及び副走査方向についてレジ補正量を各々演算 し、個々の画素の記録位置に対する主走査方向及び副走 査方向の微調整量に従い、個々の画素の記録位置が主走 査方向及び副走査方向に各々微調整されるように制御す るので、上記効果に加え、レジずれをより高精度に補正 することができる、という効果を有する。

【0183】請求項3記載の発明は、請求項1記載の発 明において、複数の画像のレジずれとして、レジずれ量 50 【図14】 レジずれのAC成分のうち、(A)及び

が一定のDC成分及びレジずれ量が周期的に変化するA C成分を各々検知し、検知したレジずれのDC成分及び AC成分に基づいてレジ補正量を演算するので、上記効 果に加え、レジずれのDC成分及びAC成分を確実に補 正することができる、という効果を有する。

【0184】請求項5記載の発明は、請求項2記載の発 明において、個々の画素の記録位置に対する主走査方向 の微調整量に従い、個々の画素を記録する期間を、個々 の画素の記録周期に相当する期間内で時間的にずらすこ とにより、画素の記録位置を主走査方向に微調整させる ので、上記効果に加え、装置コストの増大を抑制すると とができる、という効果を有する。

【0185】請求項6記載の発明は、請求項2記載の発 明において、個々の画素の記録位置に対する副走査方向 の微調整量に従い、個々の画素の記録位置における静電 潜像の電位の分布が副走査方向へ偏倚するよう記感光体 への光ピームの照射光量を制御することにより、画素の 記録位置を副走査方向に微調整させるので、上記効果に 加え、装置コストの増大を抑制することができる、とい う効果を有する。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本実施形態に係るカラー画像形成装置の概略 構成図である。

【図2】 走査路光部の概略構成を示す平面図である。

【図3】 画像検出部の各パターン検出ユニットの配置 を示す斜視図である。

【図4】 パターン検出ユニットの概略構成を示すプロ ック図である。

【図5】 (A)はパターン検出ユニットのLED及び 【発明の効果】以上説明したように請求項1及び請求項 30 フォトダイオードの配置を示す斜視図、(B)はフォト ダイオードの受光部の形状を示す平面図である。

> 【図6】 中間転写ベルトの外周面上に形成されたシェ ブロンバターンの一例を示す平面図である。

【図7】 マイクロコンピュータ108によって実現さ れるレジ補正に係る機能を詳細な機能毎にブロックに分 けて示すと共に、LEDドライバの概略構成を示すプロ ック図である。

(A) 乃至 (F) はシェブロンパターンによ 【図8】 る色ずれ量の検知を説明するための概念図である。

40 【図9】 色ずれ補正量の設定を説明するための概念図 である。

【図10】 (A) 及び(B) は走査線傾き(スキュ ー)の補正を説明するための概念図である。

【図11】 走査線湾曲(ボウ)の補正を説明するため の概念図である。

【図12】 全体倍率変化の補正を説明するための概念 図である。

(A) 及び(B) は左右倍率変化の補正を 【図13】 説明するための概念図である。

(B) は画像形成位置のFS方向に沿った周期的な変動の補正を説明するための概略図、(C)及び(D)はSS方向に沿った周期的な濃度の補正を説明するための概略図である。

【図15】 2値展開文字の濃度ヒストグラムの一例を示す線図である。

【図16】 網点画像再現方式を説明するための概念図である。

【図17】 (A)及び(B)は文字画像データに対する解像度変換処理の一例を各々示す概念図である。

【図18】 文字画像データに対する処理(一例)の流れを示す概念図である。

【図19】 写真画像データに対する処理(一例)の流れを示す概念図である。

【図20】 (A) はゼロ次ホールド法、(B) はニアレストネイバー法、(C) は4点補間法を説明するための概念図である。

【図21】 投影法を説明するための概念図である。

【図22】 16点補間法を説明するための概念図である。

【図23】 処理領域内の高濃度部のバターン、及び各 バターンに対して設定されるコード情報の一例を示す線 図である。

【図24】 (A)はドットの記録位置の右寄せ、

(B) は中寄せ、(C) は左寄せを各々説明するための 線図である。、 *【図25】 SS方向への画素の記録位置の微調整を説明するための線図である。

【図26】 本実施形態の方式により画素の境界を斜め に横切る理想ラインを記録した結果を従来方式と比較し た図である。

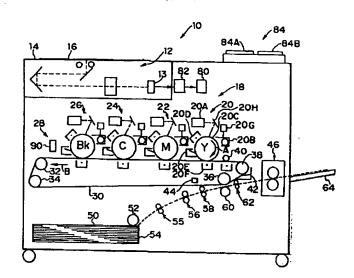
【図27】 倍率変化の他の補正方法を説明するための 概念図である。

【図28】 レジずれによって現れる各種現象を示す概念図である。

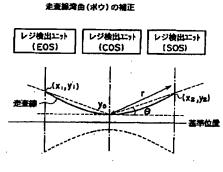
10 【符号の説明】

- 10 画像形成装置
- 20 画像形成部
- 22 画像形成部
- 24 画像形成部
- 26 画像形成部
- 108 マイクロコンピュータ
- 133 レジずれ補正量演算部
- 146 画素位置補正演算部
- 148 低解像度化演算部
- 20 150 コード情報設定部
 - 154 D/A変換器
 - 156 比較器
 - 158 三角波信号生成回路
 - 160 セレクタ
 - 162 光量制御部

【図1】

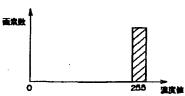


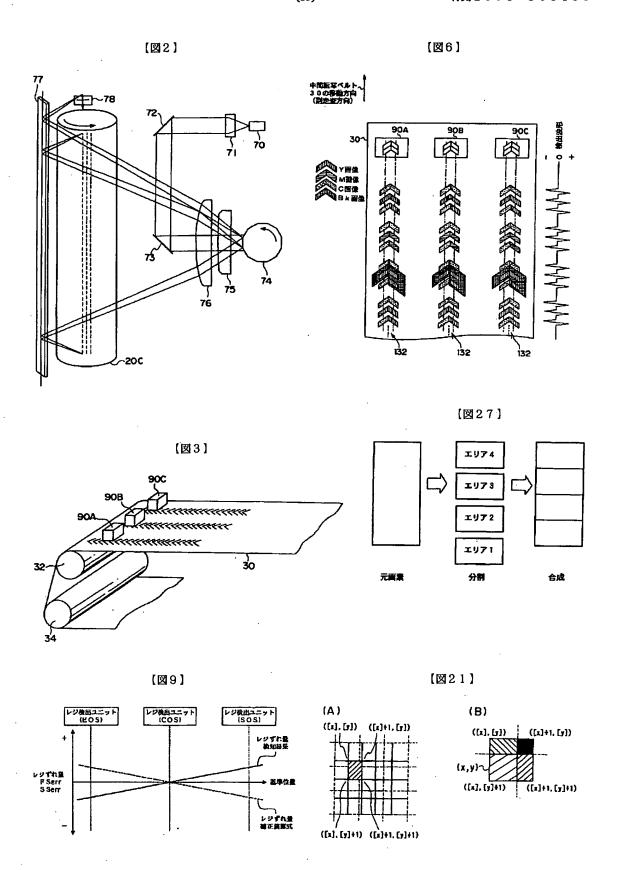
【図11】



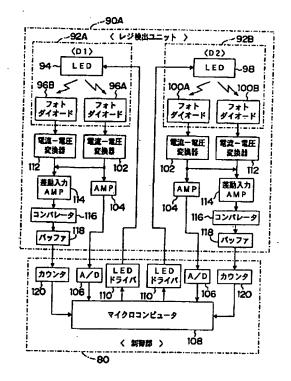
(2値展開文字画像の濃度ヒストグラムの一例)

【図15】



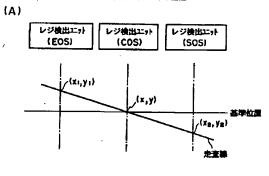


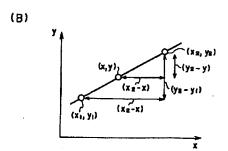
【図4】



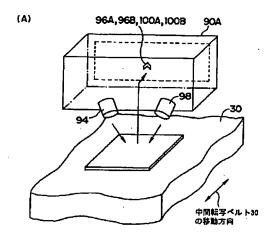
【図10】

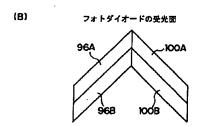
走査機模さ(スキュー)の補正





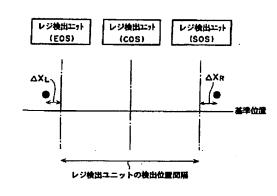
【図5】



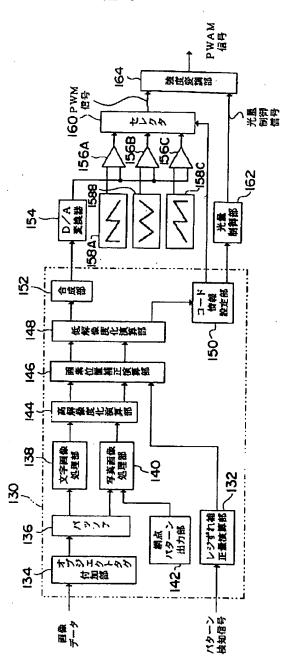


【図12】

全体倍率変化の補正



【図7】





(C) 主走査方向へのずれ祭(I) 点線色のパターンが実験色の パターンに対してFS方向に マイナスでずれている。



. (D) 主走査方向へのずれ例(2) 点着色のパターンが実施色の パターンに対してFS方向に ブラスでずれている。



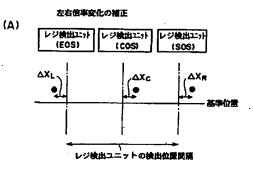
(E) 主走査方向へのずれ例(1) 点線色のパターンが実験色の パターンに対してSS方向に プラスアポカアリス



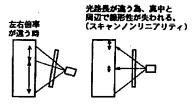
(F)主定空方向へのずれ例(2) 点線色のパターンが実線色の パターンに対してSS方向に マイナスでずれている。



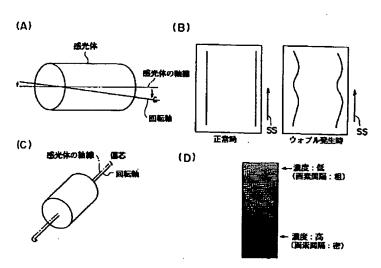
【図13】



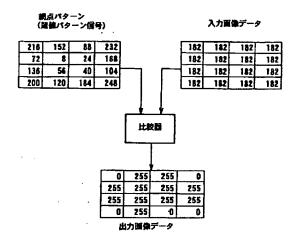
(B) <u>E#6</u>



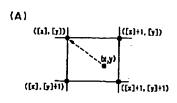
【図14】

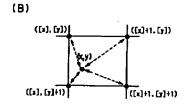


【図16】

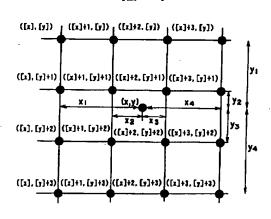


【図20】

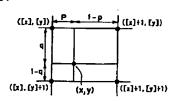




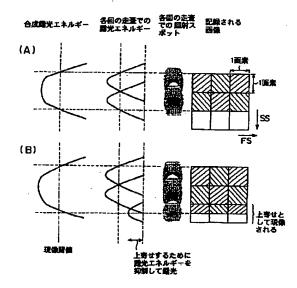
【図22】



(C)



【図25】

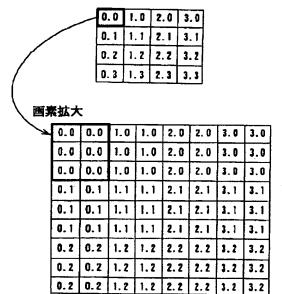


【図17】

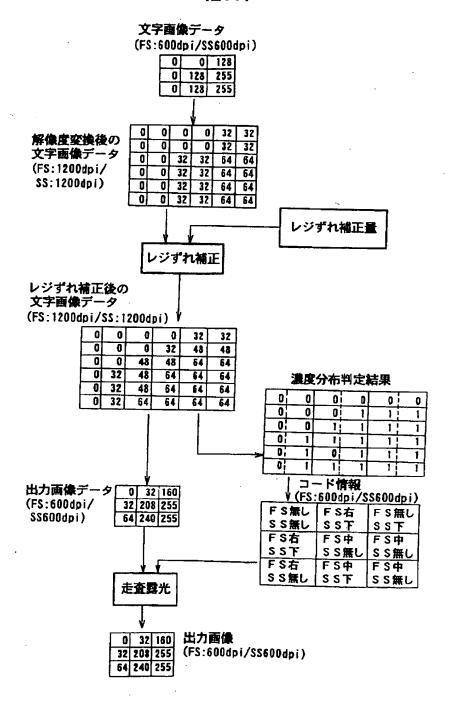
(A)

		0	0 1	28					
		0 1	28 2	255					
	L	0 1	28 2	255					
0	0	0	0	32	32				
0	0	0	0	32	32				
0	0	32	32	64	64				
0	0	32	32	64	64				
0	0	32	. 32	64	64				
0	0	32	32	64	64				

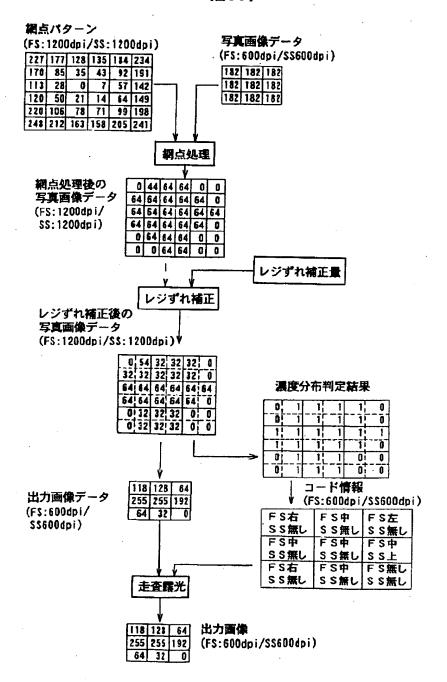
(B)



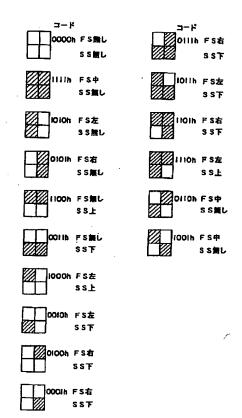
【図18】



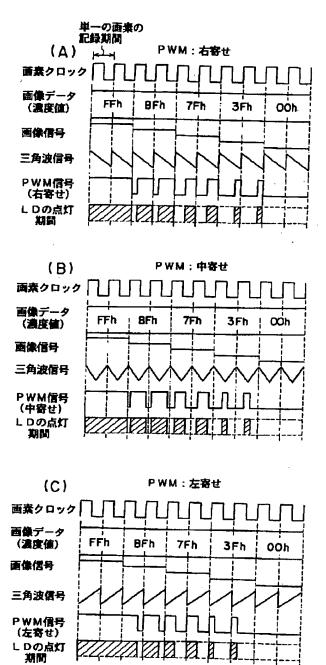
【図19】



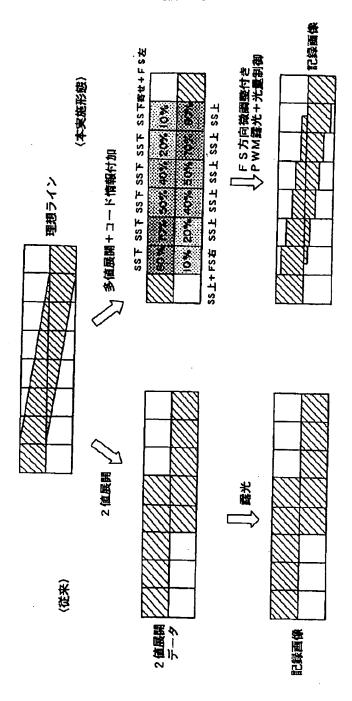
【図23】



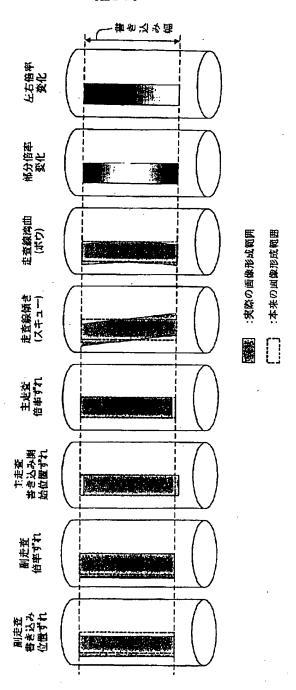
【図24】



【図26】



【図28】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.' 識別記号 G06T 1/00 510 H04N 1/113 F I H 0 4 N 1/387 B 4 1 J 3/00 テーマコード (参考) 5 C O 7 6 B 5 C O 7 7 1/387 1/40

H04N 1/04 104A

1/40

101Z

Fターム(参考) 2C262 AA05 AA24 AA26 AB15 FA02

FA05 GA04 GA13

2H030 AA01 AD17 BB02 BB16 BB42

BB56

58057 AA11 CA01 CA08 CA12 CB01

CB08 CB12 CC01 CD05 CE02

CE16 DA07 DB02 DB06 DB09

DC22

5C072 AA03 BA17 BA19 HA02 HA13

HB08 QA14 QA17

5C074 AA02 AA10 BB03 BB16 DD05

DD11 DD15 DD19 FF15

5C076 AA21 AA32 BA02 BA06 BB04

5C077 LL19 MM27 MP08 PP20 PP39

PP43 PQ12 SS02 TT03